



KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG
KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG
1026 Budapest, Riadó u. 5.
Tel.: 06-1/882-8594
Elektronikus kapcsolattartás: kozbeszerzes.hu

Iktatószám: D.676/14/2024.

A tanács tagjai: Dr. Szvetnik Ágnes közbeszerzési biztos, az eljáró tanács elnöke, Bonifert Zsolt közbeszerzési biztos, Hubáné Dr. Szabó Ágnes közbeszerzési biztos

A kezdeményező: Integritás Hatóság
(Budapest, Széchenyi István tér 7-8.)

A kezdeményező képviselője: Dr. Nagy Gizella kamarai jogtanácsos

Az ajánlatkérő: Szegedi Tudományegyetem
(Szeged Dugonics tér 13.)

Az ajánlatkérő képviselője: Dr. Nagy Paulina kamarai jogtanácsos

Az érdekelt: JEOL (Europe) SAS
(78290 Croissy-Sur-Seine, Allée de Giverny 1.)

Az érdekelt képviselője: Dr. Rektenwald Fanni ügyvéd
(Budapest, Bem rakpart 43. 1/107.)

A beszerzés tárgya, értéke: „Elektronmikroszkóp kutatórendszer beszerzése II.” - 2. rész
Pásztázó mikroszkóp, 245.679.150.-Ft

Az eljárás EKR azonosítószáma: EKR000062712024

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T – ot.

A Döntőbizottság jogsértés hiányát állapítja meg.

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket az ügyfelek maguk viselik.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat ellen a Fővárosi Törvényszék előtt közigazgatási per indítható annak kézbesítésétől számított tizenöt napon belül. A keresetlevelet Fővárosi Törvényszékhez címezve, de kizárólag a Döntőbizottsághoz kell elektronikus úton benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására/közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

I N D O K O L Á S

A jogorvoslat alapjául szolgáló tényállás

1. Az ajánlatkérő 2024. április 12. napján feladott hirdetménnyel a Kbt. Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított, melynek ajánlati felhívása az Európai Unió

Hivatalos lapjában 220607-2024. számon 2024. április 15. napján jelent meg. A közbeszerzési eljárás EKR azonosítószáma: EKR000062712024 volt.

2. A felhívás az alábbiakat is tartalmazta:

5.1. Rész: LOT-0002

Cím: Pásztázó elektronmikroszkóp

Leírás: A közbeszerzés eredményeként megkötendő adásvételi szerződés teljesítése keretében a nyertes ajánlattevő feladata egy darab pásztázó elektronmikroszkóp eszköz (a továbbiakban: Eszköz) Ajánlatkérő részére történő szállítása, telepítése és rendeltetésszerű használatra történő üzembe helyezése, amely magában foglalja a működtetéshez szükséges informatikai hardware és software komponensek leszállítását, telepítését és rendeltetésszerű használatra történő üzembe helyezését is. A nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a Műszaki leírásban, valamint a Szerződéstervezetben meghatározott kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. A beszerzésre kerülő Eszköz a közbeszerzési eljárás 1. részében beszerzendő elektronmikroszkóp rendszerrel integráltan a makromolekula szintű háromdimenziós struktúra kutatás modern eszközhátterét képezi, amellyel a minták szerkezeti tulajdonságai informatív vizuális reprezentációkkal képezhetők le, lehetővé téve a kutatási témák mechanikus szerkezeti tulajdonságokon alapuló vizsgálatát. Az Eszköz elektronmikroszkóp rendszerbe való integrációja érdekében szükséges illesztések, fejlesztések elvégzése a 2. részben nyertes ajánlattevő feladatát képezik (Eszköz integrációja).

Mennyiség:

1 db elektronmikroszkóp és tartozékai:

--1 db Pásztázó elektronmikroszkóp SBFI technikához

A célminta alanyok kiválasztásához automatizált szerkezeti mikrotóm tomográfiás mikroszkóp, SBFI (serial block face imaging) technikához, nagy fényerejű téremissziós elektronforrás legnagyobb nyalábáram 10 kV-on legalább 400 nA. Az Eszköznek, valamint valamennyi tartozékának (beleértve a szoftverlicencket is) újnak (használatban még nem volt) kell lennie. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) termékek szállítására, tehát csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo termékek szállítása megengedett.

Kapcsolódó szolgáltatások:

--A 24 hónap teljeskörű jótállás időtartama alatt karbantartás, hibaelhárítás és javítás

--Üzemeltető és karbantartó személyzet betanítása különböző naptári napokon min. 2 x 4 óra, max. 6 fő részére

--Kutatói felhasználói betanítás különböző naptárinapokon min. 3 x 6 óra, max. 6 fő részére

--12 hónap Felhasználói támogatás (support) ellátása a teljeskörű jótállásidőtartama alatt

--Szoftverek felhasználhatóságának, frissítésének biztosítása a teljeskörű jótállás időtartama alatt

--Eszköz integrációja

A megajánlott termékekkel, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes elvárásokat a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Műszaki Leírás, és a Szerződéstervezet tartalmazza. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot az előírt, vagy az azzal egyenértékű termékre lehet tenni, Ajánlatkérő az egyenértékűséget az általa a műszaki leírásban meghatározott paraméterek tekintetében vizsgálja.

3. Az ajánlatkérő értékelési szempontként az alábbiakat rögzítette:

Kritérium:

Minőség

1. Pásztázó elektronmikroszkóp SBFi technikához műszaki paramétere - Felbontás szekunder elektronokkal nagyvákuumban 15 kV-on - (1,2-0,8 nm)

Súlyozás (pontok, pontos): 5

Kritérium:

Minőség

2. Pásztázó elektronmikroszkóp SBFi technikához műszaki paramétere - Felbontás szekunder elektronokkal nagyvákuumban 1 kV-on - (1,5-1,0 nm)

Súlyozás (pontok, pontos): 5

Kritérium:

Minőség

3. Pásztázó elektronmikroszkóp SBFi technikához műszaki paramétere - Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 15 kV-on - (1,8-1,2 nm)

Súlyozás (pontok, pontos): 5

Kritérium:

Minőség

4. Pásztázó elektronmikroszkóp SBFi technikához műszaki paramétere - Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 3 kV-on - (2,7-1,8 nm)

Súlyozás (pontok, pontos): 5

Kritérium:

Ár

5. Nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyozás (pontok, pontos): 80

4. Az ajánlatkérő a felhívás mellé dokumentációt is készített, melyben az alábbiakat is rögzítette:

2. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására két közbeszerzési részben került sor:

(...)

2. közbeszerzési rész: Pásztázó elektronmikroszkóp

1. Pásztázó elektronmikroszkóp SBFi technikához műszaki paramétere - Felbontás szekunder elektronokkal nagyvákuumban 15 kV-on – (1,2-0,8 nm): 0,8 nm

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a jelen értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott megajánlás nem lehet. Amennyiben az ajánlattevő az alábbiaknál kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül.

(...)

2. Pásztázó elektronmikroszkóp SBFi technikához műszaki paramétere - Felbontás szekunder elektronokkal nagyvákuumban 1 kV-on – (1,5-1,0 nm): 1,0 nm

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a jelen értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott megajánlás nem lehet. Amennyiben az ajánlattevő az alábbiaknál kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül.

(...)

3. Pásztázó elektronmikroszkóp SBFi technikához műszaki paramétere - Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 15 kV-on – (1,8-1,2 nm): 1,2 nm

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a jelen értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott megajánlás nem lehet. Amennyiben az ajánlattevő az alábbiaknál kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül.

(...)

4. Pásztázó elektronmikroszkóp SBFI technikához műszaki paramétere - Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 3 kV-on – (2,7-1,8 nm): 1,8 nm

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a jelen értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott megajánlás nem lehet. Amennyiben az ajánlattevő az alábbiaknál kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül.

(...)

5. Az ajánlatkérő a 2. részhez Műszaki leírást is készített, melyben az alábbiakat is előírta:
A beszerzendő eszköz:

(1. sz tenderlap) 1 db Pásztázó elektronmikroszkóp SBFI technikához (a közbeszerzési eljárás 1. közbeszerzési részének tárgyát képező elektronmikroszkóp rendszerbe kerül integrációra)

Ajánlatkérő elvárása, hogy az átadott Eszköznek a közbeszerzési eljárás 1. közbeszerzési részének tárgyát képező elektronmikroszkóp rendszerbe integráltan, azzal kompatibilisen működni kell legalább az alábbi szinteken:

- közös képadatbázis formátum, mely minden eszközön hálózati kapcsolaton keresztül elérhetővé és kezelhetővé teszi az egyes berendezéseken készült képanyagot (minimum az 1. rész 1. sz, 2. sz, 3. sz, és 6. sz eszközeivel)
- közös szoftveres koordinációs formátum, mely minden eszközön a hálózati kapcsolaton keresztül elérhetővé és kezelhetővé teszi a korrelációs munkafolyamatokat (minimum az 1. rész 1. sz, 2. sz, 3. sz és 6. sz eszközeivel)

Az Eszköznek a közbeszerzési eljárás 1. közbeszerzési részének tárgyát képező elektronmikroszkóp rendszerbe való integrációja érdekében szükséges illesztések, fejlesztések elvégzése a 2. közbeszerzési részben nyertes ajánlattevő feladatát képezik.

Előírt követelmény	Elvárás	Súlyszám	A megajánlott készülék jellemzője (mértékegység feltüntetésével)
Gyártó	Kérjük megadni		
Típus	Kérjük megadni		
Származási hely	Kérjük megadni		
<u>Mikroszkóp oszlop</u>			
Kölcsönhatási energia tartomány (fokozatmentesen változtatható a tartományon belül)	Kérjük megadni legalább 20 eV-30 000 eV vagy bővebb		

<p>Értékelési szempont Felbontás szekunder elektronokkal nagyvákuumban 15 kV-on</p>	<p>Kérjük megadni Felbontás szekunder elektronokkal nagyvá- kuumban 15 kV-on maximum 1,2 nm. Előny a kisebb érték! A 1,2 nm feletti értékek érvénytelenek, a 0,8 nm vagy az alatti értékek maximális pontot kapnak, a köztes értékek lineáris arányosítás szerint kapnak pontszámot. Legkedvezőbb: 0,8 nm Legkedvezőtlenebb: 1,2 nm</p>	5	
<p>Értékelési szempont Felbontás szekunder elektronokkal nagyvákuumban 1 kV-on</p>	<p>Kérjük megadni Felbontása szekunder elektronokkal nagyvákuumban 1 kV- on Maximum 1,5 nm. Előny a kisebb érték! A 1,5 nm feletti értékek érvénytelenek, a 1,0 nm vagy az alatti értékek maximális pontot kapnak, a köztes értékek lineáris arányosítás szerint kapnak pontszámot. Legkedvezőbb: 1,0 nm Legkedvezőtlenebb: 1,5 nm</p>	5	
<p>Értékelési szempont Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 15 kV-on</p>	<p>Igen, kérjük megadni! Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 15 kV-on maximum 1,8 nm. Előny a kisebb érték! A 1,8 nm feletti értékek érvénytelenek, a 1,2 nm vagy az alatti értékek maximális pontot kapnak, a köztes értékek lineáris arányosítás szerint kapnak pontszámot. Legkedvezőbb: 1,2 nm legkedvezőtlenebb: 1,8 nm</p>	5	

Értékelési szempont Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 3 kV-on	Kérjük megadni Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 3 kV-on maximum 2,7 nm. Előny a kisebb érték! A 2,7 nm feletti értékek érvénytelenek, a 1,8 nm vagy az alatti értékek maximális pontot kapnak, a köztes értékek lineáris arányosítás szerint kapnak pontszámot. Legkedvezőbb: 1,8nm Legkedvezőtlenebb: 2,7 nm	5	
Kisvákuum nyomástartomány	Kérjük megadni 10 -500 Pa vagy bővebb		
Akkumulátoros védelem az iongetter tápegységben	Igen		
Mintaasztal A mintadöntés tartománya	Kérjük megadni -5°- +90° vagy bővebb		
Mintaasztal A mintaasztal analitikai munkatávolságon legyen mechanikusan eucentrikus	Igen		
In-lens rendszerű szegmentált visszaszórt elektron detektor	Igen		
Szoftverből vezérelhetően betolható - kihúzható szilárdtest detektor visszaszórt elektronokhoz, koncentrikus gyűrű alakú szegmensekkel	Igen		
Infravörös megvilágítású, élőképet adó CCD kamera a kamrában, mely a szekunder elektron képalkotással egyidőben is használható. Visszaszórt elektron detektor használatakor az infravörös megvilágítás automatikusan lekapcsol.	Igen		
<u>Kamrába épített mikrotóm</u>			
A mikrotóm kezelő funkciói legyenek a mikroszkóp szoftveres felhasználói felületébe integráltak	Igen		

6. Az érdekelt 2024. május 2. napján előzetes vitarendezési eljárást kezdeményezett a 2. rész vonatkozásában, melyben az alábbiakat fejtette ki:

„Előzmények

Ajánlatkérő által 2022. évben EKR000469852022 iktatószámon lefolytatott, jelen közbeszerzési eljárás előzményének tekinthető eljárása során előzetes vitarendezési kérelmet nyújtottunk be annak okán, hogy megítélésünk szerint Ajánlatkérő által alkalmazott feltételrendszer ellehetetleníti a Thermo Fisher gyártó termékein túl bármely más termék

megajánlását, ezzel lényegében megszüntetve a versenyt. Ajánlatkérő azon vitarendezési kérelmünket elutasította, és a beérkezett két ajánlat mellett az eljárást eredményessé nyilvánítva lezárta, a szerződés teljesítésére ugyanakkor nem került sor.

A jelen közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően Ajánlatkérő az EKR001730652023 azonosítószámú előzetes piaci konzultációt folytatott le, melynek keretében közzétett műszaki feltételrendszer tekintetében ismételten jeleztük, hogy az súlyosan versenykorlátozó, Ajánlatkérő pedig egyes feltételek tekintetében el is fogadta a javaslatunkat, de összességében továbbra sem biztosítja a tisztességes verseny feltételeit az EKR000062712024 számú megindított közbeszerzési eljárás egyik része tekintetében sem. Ezen állításunkat az alábbiak szerint támasztjuk alá.

(...)

3. Kérelmi elem: a műszaki leírás versenykorlátozó jellege a 2. rész tekintetében

A pásztázó elektronmikroszkóp ugyan külön részként megajánlható, a termékkel szemben meghatározott ajánlatkérői műszaki előírások ugyanakkor nem változtak az előző, korábban már kifogásolt specifikációhoz képest, mely alapján a piacon elérhető termékek közül továbbra is csak egy gyártó képezt műszakilag megfelelni:

Műszaki paraméter	Gyártó megnevezése			
1 db Pásztázó elektronmikroszkóp SBFI technikához	Thermo Fisher	JEOL	TESCAN	ZEISS
Nagy fényerejű téremissziós elektronforrás, Legnagyobb nyalábáram 10 kV-on 400 nA, vagy több	Megfelel	Megfelel	Megfelel	Megfelel
Összetett elektromágneses -elektrosztatikus oszlop szükséges, mely ultranagy felbontású SE és BSE leképezést tesz lehetővé	Megfelel	Megfelel	Megfelel	Megfelel
Kamranomás (végvákuum) nagyvákuum üzemmódban 10-3 Pa vagy kisebb	Megfelel	Megfelel	Megfelel	Megfelel
Kisvákuum nyomástartomány 10 -500 Pa vagy bővebb	Megfelel	<u>Nem felel meg</u>	Megfelel	Megfelel
Mintaasztal X és Y mozgástartomány 100 × 100 mm vagy nagyobb	Megfelel	Megfelel	Megfelel	Megfelel
CMOS kamera vezérlése és a képkiolvasása	Megfelel	<u>Nem felel meg</u>	Megfelel	<u>Nem felel meg</u>
Mintaasztal: a mintadöntés tartománya: -5°- +90° vagy bővebb	Megfelel	<u>Nem felel meg</u>	Megfelel	<u>Nem felel meg</u>
Mintaasztal: a mintaasztal analitikai munkatávolságon legyen mechanikusan eucentrikus	Megfelel	Megfelel	<u>Nem felel meg</u>	Megfelel
Infravörös megvilágítású, élőképet adó CCD kamera a kamrában, mely a szekunder elektron képalkotással egyidőben is használható. Visszaszórt elektron detektor használatkor az infravörös megvilágítás automatikusan lekapcsol	Megfelel	<u>Nem felel meg</u>	Megfelel	Megfelel

Kérelmezői javaslat a 3. kérelmi elem tekintetében: kérjük a fentiekben meghatározott műszaki előírások módosítását az alábbiak szerint, lehetővé téve az általunk gyártott JEOL készülék megajánlását:

- Kisvákuum nyomástartomány 10 -150 Pa vagy bővebb
- Mintaasztal: a mintadöntés tartománya: -5°- +70° vagy bővebb
- Beépített kamera
- Infravörös megvilágítású, élőképet adó CCD kamera a kamrában”

7. Az ajánlatkérő 2024. május 7. napján megküldte válaszát az előzetes vitarendezési kérelemre az alábbi álláspontjával:

„1. Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az Előzetes Vitarendezési Kérelem „Előzmények” fejezetében hivatkozott, EKR001730652023 számú előzetes piaci konzultáció során, a közzétett dokumentumokkal kapcsolatosan, a műszaki leírás, valamint egyes paramétereit „versenykorlátozó jellegének” megszüntetésére konkrét javaslatokat egyáltalán nem tett.

Tekintettel továbbá arra, hogy a 2022. évben lefolytatott közbeszerzési eljárás során benyújtott előzetes vitarendezési kérelmében előadottakat is hivatkozva Előzetes Vitarendezési Kérelmében, Ajánlatkérő összevetette azokat, a jelenlegi Előzetes Vitarendezési Kérelmében előadottakkal. Megállapítható, hogy van olyan azonos műszaki

követelmény, amelyet korábban kifogásolt, a jelen Előzetes Vitarendezési Kérelmben azonban már nem. Említ olyan kifogásolt paramétert továbbá, amely a Közbeszerzési Eljárás 2. közbeszerzési részének műszaki leírásában nem is szerepel. Mindezek alapján Ajánlatkérő álláspontja szerint Kérelmező kifogásai több esetben következtelenek, gyanítható, hogy Kérelmező nem ismeri pontosan sem a saját maga által gyártott, forgalmazott eszközök képességeit, sem a piacon tevékenykedő más gyártók termékeit.

A fentiek alapján Ajánlatkérő visszautasítja Kérelmező azon - tényként bemutatott - állításait, mely szerint a műszaki leírásban meghatározottaknak bizonyosan csak egyetlen gyártó termékei felelnek meg. Ennek megállapításához Kérelmező nyilvánvalóan megfelelő ismeretekkel nem rendelkezik, továbbá a megkövetelt körültekintést sem tanúsítja.

Az előzetes piaci konzultáció intézménye ezen bizonytalanságok, nyilvános forrásokból meg nem ismerhető körülmények felismerésére, Ajánlatkérő és az érintett piaci szegmensben tevékenykedő gazdasági szereplők közötti, a Kbt. alapelveit tiszteletben tartó kommunikáció megteremtésére szolgálna. Ennek során Ajánlatkérő bármely gazdasági szereplő számára lehetővé tette észrevételek, javaslatok megfogalmazását, mivel komplex beszerzési igényről van szó, az egyes termékek folyamatos fejlesztés alatt állnak, a nyilvánosan elérhető „katalógusban” szereplő paraméterekhez képest adott esetben már fejlettebb megoldásokkal, jobb potenciális képességekkel rendelkezhetnek.

2. Ajánlatkérő hivatkozik a Közbeszerzési Döntőbizottság következetes, elvi élel kimondott gyakorlatára. A D.41/16 /2013. iktatószámú határozat. szerint: „(...) maga határozza meg a beszerzési igényét, ezen belül azokat a műszaki jellemzőket, amelyeket az ajánlattevőktől elvár. Az ajánlatkérő, mint közpénzt felhasználó köteles biztosítani a verseny tisztaságát, nyilvánosságát, továbbá az esélyegyenlőséget és az egyenlő bánásmódot az ajánlattevők számára. Mindez nem jelenti azt, hogy a beszerzési igényét ne a saját szükségletének megfelelően határozhatná meg, hanem azt kellene beszereznie, amit a piac kínál, sőt amiből a piac a legtöbbet, legolcsóbbat stb. kínálja. (...) Az ajánlatkérőnek a saját, tényleges szükségleteinek megfelelően kell a Kbt. korlátai között meghatároznia elvárásait a saját igényeihez, nem pedig a többségi kínálati piachoz, vagy a kérelmezőhöz kell igazítania.

Mindezek alapján Ajánlatkérőnek szuverén joga van ahhoz, hogy a Kbt. és a további vonatkozó jogszabályok keretei között a beszerzés tárgyát, annak elvárt műszaki jellemzőit a ténylegesen felmerült beszerzési igényéhez igazodóan, saját maga állapíthassa meg. Ennek keretében figyelembe kell vennie különösen a Kbt. alapelvi rendelkezéseit, a Kbt. 58. §-ának rendelkezéseit, valamint 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet előírásait. Ajánlatkérő álláspontja szerint közbeszerzési dokumentumok előírásait a jogszabályi előírásoknak megfelelően, saját szükségletei szerint, semmiképpen sem jogszerűtlenül, „versenykorlátozóan” határozta meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 58. § (3) bekezdése „indokolatlanul akadályozná a verseny biztosítását” fordulata alapján Ajánlatkérőnek nem feladata beszerzési igényét az adott piacon áru szállítását kívánó valamennyi gazdasági szereplő, így a Kérelmező által akár gyártott, akár forgalmazott termékek/ tulajdonságaihoz, képességeihez igazítania. Ajánlatkérő Hangsúlyozni kívánja, hogy a verseny korlátozása csak akkor tilalmazott a Kbt. alapján, amennyiben az indokolatlan, Ajánlatkérő komplex elvárásait pedig a beszerzési igény megvalósításának célja indokolttá teszi.

3. Ajánlatkérő a Kérelmező által a 2. közbeszerzési részben kifogásolt műszaki követelmények vonatkozásában tételesen, táblázatos formában mutatja be Kérelmező kifogásait, javaslatát a vélelmezett jogsértés megszüntetésére, amely kimerül abban, hogy Ajánlatkérő beszerzési igényének műszaki leírását a Kérelmező által gyártott, forgalmazott eszköz képességeihez teljes mértékben igazítsa. A táblázat tartalmazza Ajánlatkérő ténybeli és jogi álláspontját, amelyek igazolják, hogy Kérelmező állítása helytelen, mely szerint egyetlen gyártó terméke felel meg a műszaki leírásnak. Ajánlatkérő részletesen bemutatja a kifogásolt

követelmények vonatkozásában azon indokait is, amelyek alapján azok nem indokolatlanul versenykorlátozóak.

Ajánlatkérő jelzi továbbá, hogy sehol nem írt elő olyan követelményt, hogy csak jelenleg forgalomban lévő eszköz, tartozékok szállítását fogadja el. Ajánlatkérő beszerzési igényének teljesítése - piackutatása alapján - egyes esetekben megkövetelheti a forgalomban lévő, „katalógusban szereplő” eszközök átalakítását, és/vagy moduláris bővítését, amelyekre több esetben is utal a lenti táblázatban.

A tudományterület, valamint az azt kiszolgáló ipar sajátossága, hogy az elérhető termékek „kísérleti jellegűek”, sokszor prototípusoknak tekinthetők, rövid termékciklusokkal, folyamatos fejlesztésekkel. Ebből következik a piac azon sajátossága, hogy sok esetben egy adott időpontban elérhető terméktípus beérkezett megrendelés alapján történő legyártása a katalógusban szereplő paraméterekhez képest adott esetben már fejlettebb megoldásokkal, jobb potenciális képességekkel fog megtörténni. Ez részben magyarázatot adhat arra az 1. pontban részletezett ellentmondásra is, hogy a Kérelmező által korábban kifogásolt műszaki követelmények az Előzetes Vitarendezési Kérelemben már nem szerepelnek. Ilyen esetekben feltételezhetően Kérelmező eszközeinél is technológiai előrelépés, termékátalakítás, vagy moduláris bővítés következett be.

Kifogásolt műszaki paraméter	Kérelmező kifogása, javaslata	2022. évben adott válasz
1 db Páztázó elektronmikroszkóp SBFi technikához		
Kisvákuum nyomástartomány: 10 -500 Pa vagy bővebb	„nem változtak az előző, korábban már kifogásolt specifikációhoz képest, mely alapján a piacon elérhető termékek közül továbbra is csak egy gyártó képest műszakilag megfelelni” <u>Konkrét javaslat:</u> Kisvákuum nyomástartomány: 10 -150 Pa vagy bővebb	A kamra megfelelő nyomástartománya fontos felhasználói szempont, hiszen a vizsgálandó gyantába ágyazott anyagok esetleges elektrosztatikus töltődése nem kívánt torzítást okoz. A megkövetelt 500 Pa nyomás nem szélsőséges érték, a nyilvánosan elérhető műszaki információk szerint azt több gyártó is teljesíti. Ezen tulajdonság megléte az Ajánlatkérő által beszerezni kíván csúcstechnológiás kutató eszköz felhasználhatóságához szükséges, ezért indokolt elvárása.
Mintaasztal -A mintadöntés tartománya Kérjük megadni -5°- +90° vagy bővebb	„(...) nem változtak az előző, korábban már kifogásolt specifikációhoz képest, mely alapján a piacon elérhető termékek közül továbbra is csak egy gyártó képest műszakilag megfelelni” <u>Konkrét javaslat:</u> Mintaasztal A mintadöntés tartománya Kérjük megadni -5°- +70° vagy bővebb	A tervezett vizsgálati eljárások során szükséges a minták teljes, minden irányból történő vizsgálhatósága, keresztmetszeti felületek leképezése, mely a megjelölt forgatási intervallum mellett lehetséges. Ez egy csúcstechnológiás kutató eszköz esetében indokolt elvárás. A megkövetelt döntési tartomány a nyilvánosan elérhető műszaki információk szerint nem szélsőséges érték, azt több gyártó is teljesíti.
CMOS kamera vezérlése és a képkiolvasása (ilyen követelmény a műszaki leírásban nem szerepel)	„(...) nem változtak az előző, korábban már kifogásolt specifikációhoz képest, mely alapján a piacon elérhető termékek közül továbbra is csak egy gyártó képest műszakilag megfelelni” <u>Konkrét javaslat:</u> Beépített kamera	Ezen eszköz vonatkozásában ilyen előírás a sem a 2022-ben lefolytatott közbeszerzési eljárásban, sem a tárgyi Közbeszerzési Eljárásban nem volt. Ez is mutatja Kérelmező következetlenségét. Amennyiben a Kérelmező esetlegesen „a Beépített, színes kamera képmérete: 6 Mpixel vagy több” követelményt kifogásolja: A kutató mikroszkópok kamera egységeinek felbontása közvetlen kihatással van az elvégzendő kutatási eredményekre. A gyors vizuális navigáció érdekében a nagyobb felbontású kamera jelentős előnyt biztosít Ajánlatkérő részére. A jelenlegi technológiai színvonal mellett a 6 Mpixeles felbontás nem szélsőséges érték. Az SBFi

		technológia az eleve apró minták (úgynevezett blokkok) és azok vágási felületeinek megfigyelése miatt különösen igényli a megfelelően nagy felbontást. A kamerák a mikroszkópok részegységét képezik, de a mikroszkóp gyártók jellemzően nem fejlesztenek saját kamera egységet, hanem harmadik fél termékét építik be/fejlesztik berendezéseikbe. Ezáltal a mikroszkóp gyártók jelen elvárást egy megfelelő tulajdonságú moduláris rész megajánlásával (minimális fejlesztéssel vagy harmadik fél termékének felhasználásával) teljesíteni tudják.
Infravörös megvilágítású, élőképet adó CCD kamera a kamrában, mely a szekunder elektron képalkotással egyidőben is használható. Visszaszórt elektron detektor használatakor az infravörös megvilágítás automatikusan lekapcsol.	„(...) <i>nem változtak az előző, korábban már kifogásolt specifikációhoz képest, mely alapján a piacon elérhető termékek közül továbbra is csak egy gyártó képest műszakilag megfelelni</i> ” <u>Konkrét javaslat:</u> Infravörös megvilágítású, élőképet adó CCD kamera a kamrában	A minta kamra megfigyelését biztosító kamera szintén moduláris egysége a mikroszkópnak. A CCD kamerák a mikroszkópok részegységét képezik, de a mikroszkóp gyártók jellemzően nem fejlesztenek saját kamera egységet, hanem harmadik fél késztermékét építik be/fejlesztik berendezéseikbe. Ezáltal a mikroszkóp gyártók jelen elvárást egy megfelelő tulajdonságú moduláris rész megajánlásával teljesíteni tudják. Azt bármelyik gyártó képes saját rendszerébe integrálni és az automatikus lekapcsolást a szükséges elektronikával megoldani. Lásd például https://deben.co.uk/e-beam-instrumentation/sem-chamberscope/

A fenti indokok alapján Ajánlatkérő Kérelmező előzetes vitarendezési kérelmet a 2. közbeszerzési részre vonatkozó III. kérelmi elem vonatkozásában elutasítja, az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeket nem módosítja.”

8. Az EKR rendszer 2024. május 13. napján az alábbi ajánlatok bontotta:

1. Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft. ajánlata:

1. Pásztázó elektronmikroszkóp SBFI technikához műszaki paramétere - Felbontás szekunder elektronokkal nagyvákuumban 15 kV-on - (1,2-0,8 nm): 0,8
2. Pásztázó elektronmikroszkóp SBFI technikához műszaki paramétere - Felbontás szekunder elektronokkal nagyvákuumban 1 kV-on - (1,5-1,0 nm): 1
3. Pásztázó elektronmikroszkóp SBFI technikához műszaki paramétere - Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 15 kV-on - (1,8-1,2 nm): 1,2
4. Pásztázó elektronmikroszkóp SBFI technikához műszaki paramétere - Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 3 kV-on - (2,7-1,8 nm): 1,8
5. Nettó ajánlati ár (HUF): 199 000 000

Előírt követelmény	Elvárás	Súlyszám	A megajánlott készülék jellemzője (mértékegység feltüntetésével)
Gyártó	Kérjük megadni		Thermo Fisher Scientific
Típus	Kérjük megadni		VolumeScope2
Származási hely	Kérjük megadni		Csehország
<u>Mikroszkóp oszlop</u>			
Kölcsönhatási energia tartomány (fokozatmentesen változtatható a tartományon belül)	Kérjük megadni legalább 20 eV-30 000 eV vagy bővebb		20eV-30.000eV

<p>Értékelési szempont Felbontás szekunder elektronokkal nagyvákuumban 15 kV-on</p>	<p>Kérjük megadni Felbontás szekunder elektronokkal nagyvákuumban 15 kV- on maximum 1,2 nm. Előny a kisebb érték! A 1,2 nm feletti értékek érvénytelenek, a 0,8 nm vagy az alatti értékek maximális pontot kapnak, a köztes értékek lineáris arányosítás szerint kapnak pontszámot. Legkedvezőbb: 0,8 nm Legkedvezőtlenebb: 1,2 nm</p>	5	0,8 nm
<p>Értékelési szempont Felbontás szekunder elektronokkal nagyvákuumban 1 kV-on</p>	<p>Kérjük megadni Felbontása szekunder elektronokkal nagyvákuumban 1 kV- on Maximum 1,5 nm. Előny a kisebb érték! A 1,5 nm feletti értékek érvénytelenek, a 1,0 nm vagy az alatti értékek maximális pontot kapnak, a köztes értékek lineáris arányosítás szerint kapnak pontszámot. Legkedvezőbb: 1,0 nm Legkedvezőtlenebb: 1,5 nm</p>	5	1,0 nm
<p>Értékelési szempont Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 15 kV-on</p>	<p>Igen, kérjük megadni! Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 15 kV-on maximum 1,8 nm. Előny a kisebb érték! A 1,8 nm feletti értékek érvénytelenek, a 1,2 nm vagy az alatti értékek maximális pontot kapnak, a köztes értékek lineáris arányosítás szerint kapnak pontszámot. Legkedvezőbb: 1,2 nm legkedvezőtlenebb: 1,8 nm</p>	5	1,2 nm

Értékelési szempont Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 3 kV-on	Kérjük megadni Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 3 kV-on maximum 2,7 nm. Előny a kisebb érték! A 2,7 nm feletti értékek érvénytelenek, a 1,8 nm vagy az alatti értékek maximális pontot kapnak, a köztes értékek lineáris arányosítás szerint kapnak pontszámot. Legkedvezőbb: 1,8 nm Legkedvezőtlenebb: 2,7 nm	5	1,8 nm
Kisvákuum nyomástartomány	Kérjük megadni 10 -500 Pa vagy bővebb		10 ... 500 Pa
Akkumulátoros védelem az iongetter tápegységben	Igen		Igen
Mintaasztal A mintadöntés tartománya	Kérjük megadni -5°- +90° vagy bővebb		-15° - +90°
Mintaasztal A mintaasztal analitikai munkatávolságon legyen mechanikusan eucentrikus	Igen		Igen
In-lens rendszerű szegmentált visszaszórt elektron detektor	Igen		Igen
Szoftverből vezérelhetően betolható - kihúzható szilárdtest detektor visszaszórt elektronokhoz, koncentrikus gyűrű alakú szegmensekkel	Igen		Igen
Infravörös megvilágítású, élőképzet adó CCD kamera a kamrában, mely a szekunder elektron képalkotással egyidőben is használható. Visszaszórt elektron detektor használatakor az infravörös megvilágítás automatikusan lekapcsol.	Igen		Igen
<u>Kamrába épített mikrotóm</u>			
A mikrotóm kezelő funkciói legyenek a mikroszkóp szoftveres felhasználói felületébe integráltak	Igen		Igen

9. Labsoft Sp. z o.o. ajánlata:

1. Pásztázó elektronmikroszkóp SBFI technikához műszaki paramétere - Felbontás szekunder elektronokkal nagyvákuumban 15 kV-on - (1,2-0,8 nm): 0,8
2. Pásztázó elektronmikroszkóp SBFI technikához műszaki paramétere - Felbontás szekunder elektronokkal nagyvákuumban 1 kV-on - (1,5-1,0 nm): 1
3. Pásztázó elektronmikroszkóp SBFI technikához műszaki paramétere - Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 15 kV-on - (1,8-1,2 nm): 1,2

4. Pásztázó elektronmikroszkóp SBFi technikához műszaki paramétere - Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 3 kV-on - (2,7-1,8 nm): 1,8

5. Nettó ajánlati ár (HUF): 212 900 000

Előírt követelmény	Elvárás	Súlyszám	A megajánlott készülék jellemzője (mértékegység feltüntetésével)
Gyártó	Kérjük megadni		Thermo Fisher
Típus	Kérjük megadni		Apreo VolumeScope
Származási hely	Kérjük megadni		Csehország
<u>Mikroszkóp oszlop</u>			
Kölcsönhatási energia tartomány (fokozatmentesen változtatható a tartományon belül)	Kérjük megadni legalább 20 eV-30 000 eV vagy bővebb		20eV – 30.000eV
Értékelési szempont Felbontás szekunder elektronokkal nagyvákuumban 15 kV-on	Kérjük megadni Felbontás szekunder elektronokkal nagyvákuumban 15 kV-on maximum 1,2 nm. Előny a kisebb érték! A 1,2 nm feletti értékek érvénytelenek, a 0,8 nm vagy az alatti értékek maximális pontot kapnak, a köztes értékek lineáris arányosítás szerint kapnak pontszámot. Legkedvezőbb: 0,8 nm Legkedvezőtlenebb: 1,2 nm	5	0,8 nm
Értékelési szempont Felbontás szekunder elektronokkal nagyvákuumban 1 kV-on	Kérjük megadni Felbontása szekunder elektronokkal nagyvákuumban 1 kV-on Maximum 1,5 nm. Előny a kisebb érték! A 1,5 nm feletti értékek érvénytelenek, a 1,0 nm vagy az alatti értékek maximális pontot kapnak, a köztes értékek lineáris arányosítás szerint kapnak pontszámot. Legkedvezőbb: 1,0 nm Legkedvezőtlenebb: 1,5 nm	5	1,0 nm

Értékelési szempont Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 15 kV-on	Igen, kérjük megadni! Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 15 kV-on maximum 1,8 nm. Előny a kisebb érték! A 1,8 nm feletti értékek érvénytelenek, a 1,2 nm vagy az alatti értékek maximális pontot kapnak, a köztes értékek lineáris arányosítás szerint kapnak pontszámot. Legkedvezőbb: 1,2 nm legkedvezőtlenebb: 1,8 nm	5	1,2 nm
Értékelési szempont Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 3 kV-on	Kérjük megadni Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 3 kV-on maximum 2,7 nm. Előny a kisebb érték! A 2,7 nm feletti értékek érvénytelenek, a 1,8 nm vagy az alatti értékek maximális pontot kapnak, a köztes értékek lineáris arányosítás szerint kapnak pontszámot. Legkedvezőbb: 1,8 nm Legkedvezőtlenebb: 2,7 nm	5	1,8 nm
Kisvákuum nyomástartomány	Kérjük megadni 10 -500 Pa vagy bővebb		10 – 500 Pa
Akkumulátoros védelem az iongetter tápegységben	Igen		Igen
Mintaasztal A mintadöntés tartománya	Kérjük megadni -5°- +90° vagy bővebb		-15° - +90°
Mintaasztal A mintaasztal analitikai munkatávolságon legyen mechanikusan eucentrikus	Igen		Igen
In-lens rendszerű szegmentált visszaszórt elektron detektor	Igen		Igen
Szoftverből vezérelhetően betolható - kihúzható szilárdtest detektor visszaszórt elektronokhoz, koncentrikus gyűrű alakú szegmensekkel	Igen		Igen

Infravörös megvilágítású, élőképet adó CCD kamera a kamrában, mely a szekunder elektron képalkotással egyidőben is használható. Visszaszórt elektron detektor használatakor az infravörös megvilágítás automatikusan lekapcsol.	Igen		Igen
<u>Kamrába épített mikrotóm</u>			
A mikrotóm kezelő funkciói legyenek a mikroszkóp szoftveres felhasználói felületébe integráltak	Igen		Igen

10. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást 2024. október 29. napján felfüggesztette.

A hivatalbóli kezdeményezés

11. A kezdeményező 2024. október 15. napján benyújtott és 2024. október 18. napján hiánypótolttal kezdeményezésében annak megállapítását kérte, hogy az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásának 2. részében a felhívás és dokumentáció több előírása is jogsértő.

12. Ismertette, hogy az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022. évi XXVII. törvény (a továbbiakban: Eufetv.) 24. § (4) bekezdése biztosítja számára, hogy a Kbt. 152. § (1) bekezdés o) pontja alapján kezdeményezheti a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását, ha a közbeszerzésekről szóló törvénybe, illetve a közbeszerzésekről szóló törvény felhatalmazása alapján alkotott rendeletbe ütköző magatartás vagy mulasztás jut a tudomására.

13. Közölte, hogy a kezdeményezés tárgyát képező közbeszerzés eljárás tervezett forrása európai uniós forrás. A felhívás II.2.13. pontja értelmében a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott programmal kapcsolatos, az uniós alapok finanszírozási azonosítója: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF), illetve a 2021-2027-es programozási időszak egyéb európai uniós forrása.

14. Rögzítette, hogy az ajánlatkérő az ajánlati felhívása VI.3.15 pontja alatt adott tájékoztatást arról, hogy közbeszerzési eljárása mindkét részét a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárásként indítja, mivel a közbeszerzési eljárás megindításakor egyik rész tekintetében sem rendelkezik a megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezettel. Az ajánlatkérő közölte, hogy támogatás iránti igényt fog benyújtani és a támogatási igénye el nem fogadását vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, mely miatt mindkét részt eredménytelennek nyilváníthatja.

15. Jelezte, hogy az ajánlatkérő a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kérte az ellenőrzést, s a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya 2024. április 3. napján adta ki a 2. számú mellékletként csatolt feltétellel támogató tartalmú, az eljárás megindítására vonatkozó tanúsítványát (MIR azonosító: 2024/02/00279/).

16. A kezdeményező az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásának mindkét része vizsgálatára a KEL/107/2/2024. számú, 2024. május 28. napján kelt végzésével az Eufetv. 5. § (3) bekezdés a) pontja, valamint a 20. § (2) bekezdése alapján hivatalból az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szerinti hatósági ellenőrzést indított, melyet mellékelve csatol. A hatósági ellenőrzést - annak lefolytatását követően - a kezdeményező mellékletként csatolt a KEL/107/16/2024. számú végzésével 2024. július 26. napján lezárta, erről értesítette az ajánlatkérőt, és közölte, hogy az Ákr. 101. § (1) bekezdés b) pontja alapján a hatósági ellenőrzés során tapasztalt jogsértések gyanúja miatt a Döntőbizottság hivatalbóli eljárását kezdeményezi.

17. Utalt arra, hogy 2024. május 28. napján napján az Eufetv. 20. §-a szerinti hatósági ellenőrzést indított mindkét részben, mely jogsértések az eljárást indító ajánlati felhívásból nem megállapíthatók. A jogsértésekről a kezdeményező a hatósági ellenőrzés során szerzett tudomást. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárása 1. és 2. része közbeszerzési dokumentumaihoz, az EKR adatokhoz 2024. május 29. napján adott hozzáférést. A kezdeményező hatósági ellenőrzését 2024. július 26. napján zárta le és ezen a napon értesítette a hatósági ellenőrzéssel érintett ügyfeleket az ellenőrzés eredményéről. A kezdeményező előadta, hogy a fentiekre tekintettel a Kbt. 152. § (2) bekezdés c) és (2a) bekezdés a) pontja szerinti határidőben nyújtja be a hivatalbóli kezdeményezését. Utalt arra, hogy a jogsértő esemény megtörténtének időpontja tekintetében a Kbt. 152. § (3) bekezdése utaló rendelkezése alapján irányadó a Kbt. 148. § (8) bekezdés a) pontja irányadó, míg a tudomásra jutási időpontjaként 2024. július 26. napját, a hatósági ellenőrzés lezárásáról szóló értesítést jelölte meg.

18. A kezdeményező 1. kezdeményezési elemében annak megállapítását kérte, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 76. § (6) bekezdés c) pontját, a Kbt. 77. § (1) bekezdését, a Kbt. 2. § (2) bekezdését és a Kbt. 58. (2)-(3) bekezdését a „Pásztázó elektronmikroszkóp SBFI technikához műszaki paramétere - Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 3 kV-on – (2,7-1,8 nm)” és a hiánypótlásában kiegészített „Pásztázó elektronmikroszkóp SBFI technikához műszaki paramétere - Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 15 kV-on – (1,8-1,2 nm)” minőségi értékelési szempontra vonatkozó értékelési előírások és érvénytelenségi ok jogsértő meghatározásával.

19. Kifejtette, hogy az ajánlatkérő a dokumentáció 16.2.4. pontjában „a Pásztázó elektronmikroszkóp SBFI technikához műszaki paramétere - Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 3 kV-on – (2,7-1,8 nm)” minőségi értékelési szempontra az alábbiakat írta elő.

20. „16.2.4. Pásztázó elektronmikroszkóp SBFI technikához műszaki paramétere - Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 3 kV-on – (2,7-1,8 nm)

Ezen értékelési szempont esetében az ajánlatok összehasonlításának alapját a Rendszer részét képező, megajánlott „Pásztázó elektronmikroszkóp SBFI technikához” termék Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 3 kV-on értéke képezi.

Az értéket a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő Felolvasólapon, egy tizedesjegy pontossággal kell megadni. /Előny a kisebb érték! /

A Kbt. 77. § (1) bekezdésével kapcsolatos előírások: Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a jelen értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az adható pontszám felső határával azonos számú pontszámot ad és ebben az esetben az Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el,

hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál:

4. Pásztázó elektronmikroszkóp SBFI technikához műszaki paramétere - Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 3 kV-on – (2,7-1,8 nm): 1,8 nm

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a jelen értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott megajánlás nem lehet. Amennyiben az ajánlattevő az alábbiaknál kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül.

4. Pásztázó elektronmikroszkóp SBFI technikához műszaki paramétere - Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 3 kV-on – (2,7-1,8 nm): 2,7 nm”

21. Kiemelte, hogy az ajánlatkérő az 1. sz. tenderlapon kifejezetten rögzítette is, hogy a 2,7 nm feletti értékek érvénytelenek.

22. A kezdeményező szerint megállapítható, hogy egyik gyártó a Tescan Group a.s. pásztázó elektronmikroszkópjának értéke 2,7 nm feletti, 3 nm, így az egyébként szakmai szempontból megfelelően működő pásztázó elektronmikroszkópjával a közbeszerzési versenyben nem vehet részt.

23. A hiánypótlásában kiegészített kezdeményezési elemében ismertette, hogy az ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentáció 16.2.3. pontjában „Pásztázó elektronmikroszkóp SBFI technikához műszaki paramétere - Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 15 kV-on – (1,8-1,2 nm)” minőségi értékelési szempontra az alábbiakat írta elő.

24. „16.2.3. 16.2.3. Pásztázó elektronmikroszkóp SBFI technikához műszaki paramétere - Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 15 kV-on – (1,8-1,2 nm)

Ezen értékelési szempont esetében az ajánlatok összehasonlításának alapját a Rendszer részét képező, megajánlott 'Pásztázó elektronmikroszkóp SBFI technikához' termék Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 15 kV-on értéke képezi.

Az értéket a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő Felolvasólapon, egy tizedesjegy pontossággal kell megadni. /Előny a kisebb érték! /

(...)

3. Pásztázó elektronmikroszkóp SBFI technikához műszaki paramétere - Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 15 kV-on – (1,8-1,2 nm): 1,2 nm

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a jelen értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott megajánlás nem lehet. Amennyiben az ajánlattevő az alábbiaknál kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül.

3. Pásztázó elektronmikroszkóp SBFI technikához műszaki paramétere - Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 15 kV-on – (1,8-1,2 nm): 1,8 nm

Az Ajánlatkérő a Műszaki Leírás 1. sz. tenderlapon kifejezetten rögzítette is, hogy az 1,8 nm feletti értékek érvénytelenek. Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 15 kV-on maximum 1,8 nm.”

25. A kezdeményező szerint megállapítható, hogy egyik gyártó a Tescan Group a.s. pásztázó elektronmikroszkópja számos műszaki jellemzőjét méri, de a „Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 15 kV-on” tekintetében gyártói adat nem áll rendelkezésre, mivel a gyártó nagyvákuumban 30 kV-on méri az értékét, és akkor a felbontás 1.8 nm.

26. A Kbt. 58. § (2) és (3) bekezdése szerinti indokoltsági és arányossági követelménynek való megfelelés ezen 15 kV-on előírt határérték tekintetében nem állapítható meg. A gyártók szakcégek, akik termékek releváns műszaki jellemzőit mérésekkel dokumentálják, az a körülmény ebben az esetben még gyártói mért adat sem áll rendelkezésre megkérdőjelezi az indokoltóságát és az arányossági követelménynek való megfelelését.

27. Utalt arra, hogy a gyártók szakcégek, akik termékek releváns műszaki jellemzőit mérésekkel dokumentálják, az a körülmény, hogy ebben az esetben még gyártói mért adat sem áll rendelkezésre megkérdőjelezi az indokoltóságát és az arányossági követelménynek való megfelelését.

28. A kezdeményező 2-10. kezdeményezési elemében az ajánlatkérő műszaki leírását vitatta annak jogsértő jellegére tekintettel, ami a Kbt. 58. § (2)-(3) bekezdése és a 2. § (2) bekezdése megsértését eredményezi.

29. A kezdeményező szerint megállapítható, hogy a pásztázó elektronmikroszkópokat szélesebb gyártói piaci kör gyárt, több gyártó is érdekelt ebben a piaci szegmensben, így például a Thermo Fisher Scientific Inc., az érdekelt, a Tescan Group a.s. és a ZEISS.

30. Ezen széles gyártói piaci kör ellenére a közbeszerzési eljárás 2. részében is kizárólag egy gyártó, a Thermo Fisher Scientific Inc. pásztázó elektronmikroszkópja került megajánlásra, a gyártó két kizárólagos forgalmazója részéről, miként az 1. részben.

31. Kifejtette, hogy az ajánlatkérő a műszaki leírásban összesen 46 kötelező feltételt támasztott. Ezek között az ajánlatkérő több olyan kötelező feltételt is meghatározott, melyek összehatásaként 1 gyártóra, a Thermo Fisher Scientific Inc.-re, illetve annak termékére szűkítette le a versenyt, azaz zárta ki az érdemi közbeszerzési versenyt.

32. Erre tekintettel szükséges annak vizsgálata, hogy ezek a műszaki leírási előírások megfelelnek-e a Kbt. 58. § (2) -(3) bekezdése követelményeinek lásd az 2. rész 200 M Ft feletti értékére és a közbeszerzés e része céljára tekintettel indokoltak-e és arányosok-e, indokolatlanul nem akadályozzák-e a közbeszerzési versenyt. Fontos annak kiemelése, hogy a Kbt. kógens szabályozása nem önmagában csak indokoltaságot vár el, hanem e mellett önálló követelményként jelenik meg az arányosság, mely a Kbt. 2. § (2) bekezdése szerinti arányos módon eljárás közbeszerzési alapelveinek a műszaki leírás tekintetében történő alkalmazási követelményének a kifejezett megerősítése.

33. Kiemelte, hogy a többi gyártó közbeszerzési versenyből való kizárását okozó ajánlatkérői jogsértő előírások alapvetően két csoportba sorolhatók:

- adott műszaki jellemző minimum, illetve maximum paraméterre határértékei akkénti meghatározása, hogy az attól kis mértékben eltérő, de funkcionálisan megfelelő pásztázó elektronmikroszkóp már nem megajánlható, azt érvénytelenné nyilvánítaná,
- az adott műszaki elvárását olyan konkrét módon határozta meg, hogy azzal egyenértékű funkcionális hatást biztosító más fajta megoldást kizárt, azt érvénytelenné nyilvánítaná.

34. A kezdeményező az alábbi műszaki előírásokat sérelmezte:

2. kezdeményezési elem: Kölcsönhatási energia tartomány (fokozatmentesen változtatható a tartományon belül) legalább 20 eV-30 000 eV vagy bővebb – melynél a minimum érték a 20

eV indokoltsága és arányossága nem állapítható meg.

3. kezdeményezési elem: Kisvákuum nyomástartomány 0-500 Pa vagy bővebb, melynél a minimum érték 0 Pa teljesíthetősége, indokoltsága és arányossága nem állapítható meg.

4. kezdeményezési elem: Akkumulátoros védelem az iongetter tápegységben – más egyenértékű módon is biztosítható az akkumulátor védelme, mint az iongetter tápegységben, emiatt indokoltsága és arányossága nem állapítható meg (lásd pl. védelmi lekapcsolási funkció).

5. kezdeményezési elem: Mintaasztal döntési tartománya -5° - $+90^{\circ}$ vagy bővebb – ettől kis mértékben eltérő, de egyenértékű módon is biztosítható mintaasztal döntési tartománya emiatt indokoltsága és arányossága nem állapítható meg.

6. kezdeményezési elem: Mintaasztal analitikai munkatávolságon legyen mechanikusan eucentrikus – más egyenértékű módon is biztosítható megfelelő mintaasztal emiatt indokoltsága és arányossága nem állapítható meg (lásd pl. computer vezérelt eucentrikus asztal).

7. kezdeményezési elem: In-lens rendszerű szegmentált visszaszórt elektron detektor – más egyenértékű módon is biztosítható megfelelő detektor emiatt indokoltsága és arányossága nem állapítható (lásd pl. szcintillációs detektor).

8. kezdeményezési elem: Szoftverből vezérelhetően betolható - kihúzható szilárdtest detektor visszaszórt elektronokhoz, koncentrikus gyűrű alakú szegmensekkel - más egyenértékű módon is biztosítható megfelelő detektor emiatt indokoltsága és arányossága nem állapítható meg (lásd pl. gyűrű alakú szegmensek nélkül).

9. kezdeményezési elem: Infravörös megvilágítású, élőképet adó CCD kamera a kamrában, mely a szekunder elektron képalkotással egyidőben is használható. visszaszórt elektron detektor használatakor az infravörös megvilágítás automatikusan lekapcsol - más egyenértékű módon is biztosítható a megfelelő felhasználási funkció, így a részletes elvárás egészének a teljes körű megfelelés követelménye indokoltsága és arányossága nem állapítható meg.

10. kezdeményezési elem: A mikrotóm kezelő funkciói legyenek a mikroszkóp szoftveres felhasználói felületébe integráltak – nem állapítható meg indokoltság és arányosság a mikroszkóp szoftveres felhasználói felületébe integráltsági követelmény tekintetében, mivel ilyen integráltság hiányában is a kezelő funkciók megfelelően használhatók.

35. A kezdeményező megítélése szerint a 2. részben is a műszaki leírás Kbt. 58. § (2) és (3) bekezdése megsértése mellett megállapítható a Kbt. 2. § (2) bekezdése sérelme is, mivel azok egyben az esélyegyenlőség tekintetében hátrányt okoztak.

36. A kezdeményező kezdeményezése alátámasztására csatolta az Image – Science Kft. – a Tescan Group a.s. magyarországi forgalmazója tájékoztatását, valamint a JEOL (Europe) Sas gyártó képviselője tájékoztatását.

37. A kezdeményező indítványozta az Ákr. 71. § (1) bekezdése alapján szakértő kirendelését. Kérte jogsértés megállapítása mellett az ajánlatkérő felhívásának és dokumentációjának megsemmisítését, valamint az ajánlatkérővel szemben bírság kiszabását.

38. A kezdeményező az ajánlatkérő észrevételére reagálva kifejtette, hogy az ajánlatkérő nem hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított, azaz nem hivatkozott sem műszaki technikai sajátosságokra, sem kizárólagos jogra az egységes rendszer biztosítása érdekében. Megjegyezte, hogy az ajánlatkérő észrevétele más pontjaiban több helyen kifejezetten úgy nyilatkozott, hogy nem követelte meg sem a homogén rendszert, sem az egységes rendszert. A kezdeményező álláspontja szerint az ajánlatkérőnek a beszerzési

igényére vonatkozó műszaki leírás és közbeszerzési előírás meghatározási joga nem korlátlan, hanem azt a Kbt. alapelvei és tételes rendelkezései korlátatai között teheti meg. A beszerzési igényre vonatkozó műszaki leírás tekintetében a jogalkotó a Kbt. 58. § (2) és (3) bekezdésében szabta meg ezeket a kógens és érdemei feltételeket: „feltéve, hogy kapcsolódnak a szerződés tárgyához [76. § (7) bekezdés], valamint annak értékéhez és céljaihoz képest arányosak.

(3) A műszaki leírásnak valamennyi gazdasági szereplő számára egyenlő hozzáférést kell lehetővé tennie, és nem lehet olyan hatása, amely indokolatlanul akadályozná a verseny biztosítását a közbeszerzés során.”

39. Rögzítette, hogy az ajánlatkérő a kifogásolt elemeknél sem az értékhez (lásd 2-3 Mrd Ft) és a célhoz arányosságra, sem az indokoltságra vonatkozó okszerű és elfogadható magyarázatot az nem adott elő.

40. Az ajánlatkérő hivatkozott a Döntőbizottság D.41/16/2013. sz. határozatára, mely elektronikus jogtár szolgáltatásra vonatkozik, így a dominánsan különböző tárgy eltérő jellemzői miatt az abban foglaltakból jelen ügyre irányadó következtetés nem vonható le. A Döntőbizottság D. 35/204/3124. sz. határozata az egybeszámítási kötelezettség megsértésére és közbeszerzési eljárás jogsértő mellőzésére vonatkozott, amikor ajánlatkérő szétbontotta, külön beszerzésben valósította meg az üzemeltetésre, gondnokságra és karbantartásra vonatkozó feladatokat, így az eltérő tényállás okán az abban foglaltak jelen ügyben nem irányadók.

41. A kezdeményező szerint önmagában a homogenitás elő nem írása még nem jelent feltétlen jogszerűséget, hanem az a követelmények összessége vizsgálata alapján ítélt meg. Az ajánlatkérő hivatkozott arra is, hogy nem írt elő olyan követelményt, hogy a jelenleg forgalomban levő eszközök, részegységek szállítását fogadja el, továbbá – megítélése szerint - megkövetelheti a forgalomba levő, „katalógusban szereplő” eszközök átalakítását és/vagy moduláris bővítését, fejlesztését.

42. A kezdeményező jogi álláspontja szerint a megalapozottság és közbeszerzési jogszerűség érdekében azt (is) kell vizsgálni, hogy van-e olyan gyártó, akinek a termékei átalakítás, bővítés és/vagy fejlesztés nélkül is megfelelnek, míg más gyártó(k) több feltétel tekintetében csak idő, humán és vagyoni ráfordításokkal lehetnének erre képesek. Ez felveti, hogy valóban indokoltak-e és arányosak-e az ajánlatkérő által támasztott feltételek. E mellett tekintettel kell lenni arra is, hogy más gyártó(k) számára milyen időtartam alatt, milyen humán és anyagi ráfordítással lenne lehetséges a specifikáció feltételeinek megfelelő termékek fejlesztése, azaz valós alternatívát jelenten-e a 30 napos ajánlatétteli, majd eljárás lefolytatási határidők mellett.

43. Kifejtette azon álláspontját, mely szerint a konkrét beszerzési tárgyak sajátosságaira és érintett feltételek jellemzőire tekintettel az ajánlatkérő közbeszerzési eljárása, illetve annak 2. része tekintetében ez nem jelent valós alternatívát.

44. Kiemelte, hogy azért tette a hivatalbóli kezdeményezése tárgyává az ajánlatkérő egyes műszaki érvényességi/érvénytelenségi előírásait, mert azokban vagy a műszaki jellemzők minimum és maximum határértékei meghúzásával vagy az adott műszaki elvárás egy gyártó megoldására jellemző megadásával jogsértően járt el.

45. A kezdeményező 5-6. számú mellékleteként becsatolta azokat az okirati bizonyítékokat, amelyekben a gyártó szakkégek szakmai szempontból jellemezték az ajánlatkérő által támasztott kötelező feltételeket, melyben táblázatos formában is összesítették, hogy az egyes gyártók, mely feltételeknek nem felelnek meg. A kezdeményező azért hivatkozott erre, mert ezekből megállapítható, hogy a feltételek összességét nézve a különböző gyártók azonos és/vagy eltérő feltételeknél „esnek ki” az érvényes, megfelelő ajánlattétel lehetőségéből.

46. Erre tekintettel az ajánlatkérő azon előadása, hogy a konkrét érvényességi követelménynél mely gyártó(k) terméke megfelelő (mellyel kívánja alátámasztani előírását) relatív, mivel ténylegesen a többi feltételre tekintettel a nevesített gyártó sem tud érvényes megfelelő ajánlatot tenni.

47. A kezdeményező szerint a Kbt. 58. § (2) és (3) bekezdése szerinti indokoltsági és arányossági követelménynek való megfelelés nem állapítható meg ezeknél a feltételeknél. Több érvénytelenségi oknál megállapítható, hogy azért megalapozatlan, mert más egyenértékű módon is biztosítható az ajánlatkérői igényeknek megfelelés, így például az akkumulátor védelme, mintaasztal döntési tartománya, mechanikus excentrikussága, a megfelelő detektorok.

Az ajánlatkérő észrevétele

48. Az ajánlatkérő érdemi észrevételében a jogsértés hiányának megállapítását kérte.

49. Kiemelte, hogy beszerzési igénye speciális jellegű, mint azt az eljárást megindító felhívásban, valamint a műszaki leírásban rögzítette, és amelyet a KFF ellenőrzése során, valamint a kezdeményező hatósági ellenőrzése során bemutatott. Az ajánlatkérő célja a beszerzési igény megvalósításával, hogy a világviszonylatban vezető kutatási potenciállal rendelkező „Core Facility”-khez, tudományos kutatólaboratóriumokhoz csatlakozzon. Az egyetemi színvonalú kutatáshoz, és a nemzetközi élenjáró kutatási programokban való részvételhez az 1. és 2. rész műszaki leírásaiban meghatározott berendezések, és az azokból összeállított egységes rendszer beszerzése szükséges.

50. Ismertette, hogy a beszerzésre kerülő rendszer a makromolekula szintű háromdimenziós struktúra kutatás modern eszközhátterét képezi, amellyel a minták szerkezeti tulajdonságai informatív vizuális reprezentációkkal képezhetők le, lehetővé téve a kutatási témák mechanikus szerkezeti tulajdonságokon alapuló vizsgálatát. Az ajánlatkérő elvárása az, hogy a rendszer, mint komplett műszeregyüttes tegye lehetővé a Single Particle Analysis rekonstrukciós kutatási eljárás teljes munkafolyamatának elvégzését, magas fokú automatizálhatóság mellett, mely magában foglalja a minták többszintű elővizsgálatát, előszűrését és az adatgyűjtést fagyasztott vékony rétegekről, fagyasztott sejtekből vagy azok szeleteiből minimum egy mikrométer vastagságig.

51. Az ilyen kutatási kapacitások létrehozásánál a fenntarthatóságot és hatékonyságot az biztosítja, hogy az egyes egységek kutatási profilja eltérő, különféle kutatási szolgáltatásokkal szolgálják az innovációt. A jelen beszerzés tárgyát képező rendszerrel elérhető csúcstechnológiás megoldást a meghatározott, különböző profilú, képességű részegységekből álló magas fokon automatizálható eszközkészlet rendszerbe építettsége és közös szinergiája adja, a létrehozandó kutató intézmény ezen egy rendszerbe szervezett 3d alapú komplex szolgáltatási profillal tud illeszkedni a nemzetközi core facility hálózatba.

52. A jelen közbeszerzéssel, két közbeszerzési részben beszerezni kívánt rendszer egy, magas fokon automatizálható mikroszkópiás laborban fogja össze a modern 3d mikroszkópiás képalkotás infrastruktúráját, a vizsgált minták előszűréstől, egészen a makromolekula szintű háromdimenziós struktúra megjelenítéséig, közös platformon egyesítve a krio-elektronmikroszkópia és a Serial Block Face Imaging technológia szerkezeti kutató technológiáját.

53. A beszerzési igény tervezése során az ajánlatkérő figyelembe vette, hogy a tervezett kutatási projektek ki fognak terjedni a sejt kutatástól kezdve a mikroműanyagok és nanoanyagok élettani hatásaira is. Ez utóbbi a közelmúltban fókuszba kerülő, a környezetvédelemhez is kapcsolódó terület különösen speciális műszerezettség igényel. Az ártalmas anyagok bejutását és eloszlását a biológiai szervezetben a sejtszintű méretskálától kezdve lehet majd vizsgálni. Innen a sejtalkotók szintjén át lehetséges az eljutás az egyes fehérjék térbeli szerkezetére gyakorolt hatásokig. A teljes folyamat leképezése és megértése funkcionális kapcsolatot igényel a leendő laboratórium eszközei között.

54. Az ajánlatkérő álláspontja szerint a beszerzési igény tervezése során meghatározott, és a beszerzési igény megvalósítása által kitűzött cél alapvető fontosságú a közbeszerzési eljárás feltételrendszerének vizsgálata során. Ennek a közbeszerzési eljárás során az előzetes vitarendezést kérelmező érdekelt általi, valamint a jogorvoslati eljárásban kezdeményező általi figyelmen kívül hagyása, vagy másodlagos, elhanyagolható szempontként való figyelembevétele nem megfelelő eljárás a közbeszerzés jogszerűségének megállapítása során.

55. Hivatkozott az előzetes vitarendezési kérelemre adott válasz I.1. pontjában foglaltakra, amelyek bemutatják a közbeszerzési eljárás során előzetes vitarendezési kérelmet előterjesztő érdekelt következtetését. Az ajánlatkérő ezt azért tartja fontosnak kiemelni, mert a jelen jogorvoslati eljárás jelentős részben az általa tett észrevételek, megfogalmazott kifogások, feltételezett jogsértések kezdeményező általi átvétele alapján van folyamatban.

Az ajánlatkérő észrevételében hivatkozott a Közbeszerzési Döntőbizottság következetes gyakorlatára. A D.41/16 /2013. iktatószámú határozat szerint: „(...) maga határozza meg a beszerzési igényét, ezen belül azokat a műszaki jellemzőket, amelyeket az ajánlattevőtől elvár. Az ajánlatkérő, mint közpénzt felhasználó köteles biztosítani a verseny tisztaságát, nyilvánosságát, továbbá az esélyegyenlőséget és az egyenlő bánásmódot az ajánlattevők számára. Mindez nem jelenti azt, hogy a beszerzési igényét ne a saját szükségletének megfelelően határozhatná meg, hanem azt kellene beszereznie, amit a piac kínál, sőt amiből a piac a legtöbbet, legolcsóbbat stb. kínálja. (...) Az ajánlatkérőnek a saját, tényleges szükségleteinek megfelelően kell a Kbt. korlátai között meghatároznia elvárásait a saját igényeihez, nem pedig a többségi kínálati piachoz, vagy a kérelmezőhöz kell igazítania.”

56. Kifejtette, hogy a fentiek alapján joga van ahhoz, hogy a Kbt. és a további vonatkozó jogszabályok keretei között a beszerzés tárgyát, annak elvárt műszaki jellemzőit a ténylegesen felmerült beszerzési igényéhez igazodóan, saját maga állapíthassa meg. Ennek keretében figyelembe kell vennie különösen a Kbt. alapvető rendelkezéseit, a Kbt. 58. §-ának rendelkezéseit, valamint 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet előírásait. Álláspontja szerint a közbeszerzési dokumentumok előírásait a jogszabályi előírásoknak megfelelően, saját szükségletei szerint, semmiképpen sem jogszerűtlenül, határozta meg. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Kbt. 58. § (3) bekezdése „indokolatlanul akadályozná a verseny biztosítását” fordulata alapján az ajánlatkérőnek nem feladata beszerzési igényét az adott piacon áru szállítását kínáló valamennyi gazdasági szereplő, így az érdekelt, vagy más gazdasági

szereplő által gyártott, forgalmazott termékek/rendszerek tulajdonságaihoz, képességeihez igazítania. Hangsúlyozta, hogy a verseny korlátozása csak akkor tilalmazott a Kbt. alapján, amennyiben az indokolatlan, az ajánlatkérő komplex elvárásait pedig a beszerzési igény megvalósításának I. fejezetben bemutatott célja indokoltá teszi.

57. Utalt a Közbeszerzési Döntőbizottság D.35/24/2024. iktatószámú határozatában foglaltakra, mely szerint „(...) A Döntőbizottság nem fogadta el a kérelmező azon kifogását, hogy (...) azért versenyszűkítő előírás az ajánlatkérő részéről, mert csak egy ajánlattevő tud ajánlatot tenni a közbeszerzési eljárásban. „(...) Irreális elvárás az, ha olyan beszerzési igény megfogalmazását és műszaki leírás elkészítését várják el az ajánlatkérőtől, amely nem az ajánlatkérő elvárásait tartalmazza, hanem a piac valamennyi szereplőjének megfelel. (...) (...) A széleskörű verseny biztosítása nem azt jelenti az ajánlatkérő számára, hogy a beszerzési igényét és a műszaki leírását a piac szereplőinek adottságaihoz, műszaki megoldásaihoz igazítsa. Azt kell szem előtt tartania, hogy a műszaki leírása egyenlő hozzáférést biztosítson és indokolatlanul ne legyen versenykorlátozó. A beszerzés tárgyával kapcsolatban megfogalmazott elvárásoknak, követelményeknek az ellátandó szolgáltatás mértékéhez képest arányosnak kell lenniük. (...)”

58. A fentiek alapján az ajánlatkérő álláspontja szerint levezethető az, hogy önmagában az a tény, hogy a műszaki leírásban előirt követelménynek csak egy gyártó, ajánlattevő, forgalmazó terméke felel meg, önmagában nem versenykorlátozó, ha a versenykorlátozás indokolt. A kezdeményező jogsértéseket feltételező állításai csupán arra az esetre vonatkoznának, ha az ajánlatkérő nem tette volna lehetővé, kizárta volna azt, hogy egyedi gyártású részegységek, eszközök elfogadhatóak legyenek.

59. Jelezte, hogy sehol nem írt elő olyan követelményt, hogy csak jelenleg forgalomban lévő eszközök, részegységek szállítását fogadja el. Az ajánlatkérő beszerzési igényének teljesítése - piackutatása alapján - egyes esetekben megkövetelheti a forgalomban lévő, „katalógusban szereplő” eszközök átalakítását, és/vagy moduláris bővítését, amelyekre több műszaki követelmény tekintetében is utalni fog. A tudományterület, valamint az azt kiszolgáló ipar sajátossága, hogy az elérhető termékek „kísérleti jellegűek”, sokszor prototípusoknak tekinthetők, rövid termékciklusokkal, folyamatos fejlesztésekkel. Ebből következik a piac azon sajátossága, hogy sok esetben egy adott időpontban elérhető terméktípus beérkezett megrendelés alapján történő legyártása a katalógusban szereplő paraméterekhez képest adott esetben már fejlettebb megoldásokkal, jobb potenciális képességekkel fog megtörténni. Ehhez kapcsolódóan az ajánlatkérő korábban is rögzítette, hogy a megajánlható termékek, rendszer esetében nem tett olyan korlátozást, mely szerint azok, a rendszer egyes részegységei csak egyetlen gyártótól származhatnak.

60. Az ajánlatkérő a kezdeményező által kifogásolt műszaki követelmények vonatkozásában tételesen mutatja be az ajánlatkérő ténybeli és jogi álláspontját, amelyek igazolják, hogy kezdeményező állítása helytelen, mely szerint egyetlen gyártó termékei felelnek meg a műszaki leírásnak. Az ajánlatkérő részletesen bemutatja az egyes kifogásolt követelmények vonatkozásában azon indokait is, amelyek alapján azok nem indokolatlanul versenykorlátozóak.

61. Az 1. kezdeményezési elem „Pásztázó elektronmikroszkóp SBF1 technikához műszaki paramétere - Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 3 kV-on – (2,7-1,8 nm)” minőségi értékelési szempontra vonatkozó értékelési előírások és érvénytelenségi ok jogsértő meghatározásával” kapcsolatos kezdeményezésre kifejtette, hogy a megcélzott kutatások

interdiszciplináris jellege megköveteli, hogy a berendezés a rendelkezésre álló paraméterter jelentős részén kiemelkedő képalkotással rendelkezzen, hogy a korszerű elektronoptika alacsony és magas gyorsítófeszültségek mellett egyaránt biztosítsa a technikailag elérhető legjobb felbontást. Biológia minták, vékonyrétegek, könnyűelemes vagy érzékeny felületű anyagtudományi minták vizsgálata esetén különösen fontos a jó felbontású alacsony energiás képalkotás, mivel alacsony energián láthatóvá válnak olyan felszíni jellegzetességek, melyek nagy gyorsítófeszültséggel nem leképezhetőek. Ezen túl az alacsony energia kevésbé ronsolja a kutatásban szerepet kapó, jellemzően érzékeny biológiai mintákat.

62. Kifejtette, hogy a kezdeményező álláspontjából levezethető, hogy szerinte a 3 nm értékű felbontás és a 2,7 nm felbontás között érdemi különbség nincs. Az ajánlatkérő ezzel nem értett egyet, annak okán sem, hogy a piacon több olyan mikroszkóp is elérhető, melynek felbontása lényegesen magasabb, így sokkal jobb minőségű képalkotás is elérhető. Utalt arra, hogy nem célja, és nem is kötelessége a legkisebb tudású eszközökhöz igazítani a beszerzési igényét.

63. Példaként említette a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatásait, ahol az idegtudományi kutatásokban szerepet kapó block face pásztázó elektronmikroszkópon folyó képalkotási munka szinte kizárólag az 1-3 kV között, alacsony gyorsítófeszültségen zajlott.

64. Rögzítette, hogy a követelménynek több ismert mikroszkóp típus (ThermoFisher, Zeiss, Jeol) is eleget tesz, az nem indokolatlanul versenykorlátozó, hanem az indokolt beszerzési igény kifejezője, így előírása nem jogsértő.

65. A 2. kezdeményezési elem Kölcsönhatási energia tartomány (fokozatmentesen változtatható a tartományon belül) legalább 20 eV-30 000 eV vagy bővebb – melynél a minimum érték a 20 eV indokltsága és arányossága, kapcsán közölte, hogy a legutóbbi évtizedben kerültek előtérbe azok a kutatási irányok, melyek kimondottan alacsony kölcsönhatási energiás leképezést igényelnek, a 10...50 eV tartományban. Ilyenek az ultravékony rétegek, 2D anyagok pl. grafén, bizonyos polimerek, ezen túl a felszíni potenciál leképezését igénylő feladatok. Extrém alacsony kölcsönhatási energia tartományban láthatóvá válnak olyan felületi jellemzők, amelyek nagyobb gyorsítófeszültséget használva korábban nem voltak megfigyelhetők, például a vizsgálandó struktúra vékonysága miatt.

66. Hangsúlyozta, hogy ennek a követelménynek több ismert mikroszkóp típus is eleget tesz, az nem versenykorlátozó, hanem a kutatási igények kifejezője. Példaképpen a Jeol 10 eV kölcsönhatási energián készült képet tette közzé:

<https://www.jeolusa.com/RESOURCES/Electron-Optics/Documents-Downloads/extreme-low-voltage-imaging>

67. Utalt arra, hogy a kezdeményező nem adta meg, hogy álláspontja szerinti milyen tartományt, értéket tartana megfelelőnek, indokoltnak, ezért álláspontja szerint a kezdeményezés nem megalapozott.

68. A 3. kezdeményezési elem Kisvákuum nyomástartomány 0-500 Pa vagy bővebb, melynél a minimum érték 0 Pa teljesíthetősége, indokltsága és arányossága nem állapítható meg” kapcsán hangsúlyozta, hogy az ajánlatkérő sehol sem írt elő az adott műszaki tulajdonság vonatkozásában 0 Pa minimumértéket.

69. Rögzítette, hogy az előírása a műszaki leírásban „Kisvákuum nyomástartomány 10 - 500 Pa vagy bővebb” volt.

70. Hangsúlyozta, hogy a kamra megfelelő nyomástartománya fontos felhasználói szempont, hiszen a vizsgálandó gyantába ágyazott anyagok esetleges elektrosztatikus töltődése nem kívánt torzítást okoz. Hasonló a helyzet a különböző, fémesen nem vezető kompozit anyagokkal, melyek egyszerre igényelnek alacsony gyorsítófeszültséget és viszonylag magas kamranyomást. A megkövetelt 500 Pa nyomás nem szélsőséges érték, a nyilvánosan elérhető műszaki információk szerint azt több gyártó is teljesíti vagy akár túlteljesíti. Például a Tescan Vega 3 típusal akár 2000 Pa kamranyomás is elérhető.

71. Ezen tulajdonság megléte az ajánlatkérő által beszerezni kíván csúcstechnológiás kutató eszköz felhasználhatóságához szükséges, ezért indokolt elvárása, így nem jogsértő.

72. A 4. kezdeményezési elem „Akkumulátoros védelem az iongetter tápegységben” előírás kapcsán az ajánlatkérő előadta, hogy a műszaki leírásban előírt követelmény nem az akkumulátor védelmét biztosítja, hanem áramszünet esetén az iongetter szivattyúk működését tartja fenn akkumulátorokkal, a vákuumrendszer védelme érdekében. Ennek hiányában egy esetleges áramszünet az iongetter szivattyúk leállásával jár. A készülék ezt követően hamarosan elveszti az ultranagy vákuumot. Azonnali beavatkozás hiányában - ez csak a szerviz beavatkozásával, a vákuumrendszer kondicionálásával hozható rendbe. Ez extra költséget és feleslegesen kieső napokat jelent. Az iongetter tápegységek akkumulátoros védelme egy akár 8 órás áramszünetet is képes áthidalni az ultranagy vákuum összeomlása nélkül.

73. Kiemelte, hogy az említett „védelmi lekapcsolási funkció” csak korlátozott védelmet nyújt, ez áramszünet esetén is képes „szabályosan” leállítani a berendezést, de a vákuumállapotot nem tartja fenn, ezért az előírás nem jogsértő.

74. Az 5. kezdeményezési elem a „Mintaasztal döntési tartománya -5 °- + 90 ° vagy bővebb” előírás kapcsán kifejtette, hogy a tervezett vizsgálati eljárások során szükséges a minták teljes, minden irányból történő vizsgálhatósága, keresztmetszeti felületek leképezése, mely a megjelölt forgatási intervallum mellett lehetséges. Pl. vékony minta keresztmetszeti vizsgálatához kifejezetten 90 fokos mintadöntés szükséges. Ez egy csúcstechnológiás kutató eszköz esetében indokolt elvárás. A megkövetelt döntési tartomány a nyilvánosan elérhető műszaki információk szerint nem szélsőséges érték, azt több gyártó is teljesíti, például a Tescan Mira 3 XM.

75. Közölte továbbá, hogy a kezdeményező nem határozta meg, hogy álláspontja szerinti milyen tartományt tartana egyenértékűnek, olyat viszont sem a Kbt., sem más jogszabályok nem írnak elő, hogy egy meghatározott mozgástartomány előíráson felül az ajánlatkérőnek külön kötelessége lenne még pl. eltérésre százalékos értéket meghatározni. Az ajánlatkérő álláspontja szerint a döntés tartományra vonatkozó előírása indokolt.

76. A 6. kezdeményezési elem a „Mintaasztal analitikai munkatávolságon legyen mechanikusan eucentrikus” – kapcsán az ajánlatkérő kifejtette, hogy az eucentrikus tulajdonság azt jelenti, hogy a mintaasztal döntése közben a mintán megfigyelt terület nem mozdul el, nem csúszik ki a képből. Ez elérhető mind a mintaasztal mechanikus felépítése révén, mind számítógépes korrekcióval („computer vezérelt eucentrikus asztal”). A két megoldás nem egyenértékű. Mechanikusan eucentrikus mintaasztal esetén a mintapozíció

beállítható úgy, hogy döntési tengely pont a vizsgált területen haladjon át, ez biztosítja, hogy a vizsgált terület mindig a képen maradjon. Computer vezérelt eucentrikus asztal esetén a számítógép a döntés függvényében korigál az X és Y tengelyek mozgásával, ennek pontossága korlátozott, a mozgás szaggatott.

77. Ismertette, hogy ezt a követelményt egyébiránt sok gyártó több ismert típusa teljesíti, így egyáltalán nem indokolatlanul versenykorlátozó az előírás.
<https://www.jeol.com/products/scientific/sem/JSM-7610FPlus.php>

78. A 7. kezdeményezési elemmel az „In-lens rendszerű szegmentált visszaszórt elektron detektor” előírás kapcsán az ajánlatkérő előadta, hogy az in-lens rendszerű detektorok nem válthatók ki nem in-lens, azaz kamrába szerelt detektorral. A megnevezett szcintillációs detektor szakmailag nem egyenértékű, amennyiben az hagyományos módon a kamrába szerelt.

79. Rámutatott arra, hogy a korszerű pásztázó elektronmikroszkópiában kiemelt szerepet játszanak az alacsony kölcsönhatási energiájú (landing voltage) leképezési eljárások. Extrém alacsony (20 V... 200 V) és alacsony (200 V ... 2 kV) tartományban láthatóvá válnak olyan felületi jellemzők, amelyek nagyobb gyorsítófeszültséget használva korábban nem voltak megfigyelhetők, például a vizsgálandó struktúra vékonysága miatt.

80. Ezt az alacsony kölcsönhatási energiát azonban hagyományos elektronoszloppal nem lehet elérni, innovatív megoldásokra van szükség, mint a nyalábfékezés technológia és az elektronoszlopba integrált, gyorsító illetve fékező elektromos mezőket létrehozó elektródák. Ezek azonban bekapcsolt állapotban módosítják a mintaasztal és az objektív pólusa környezetében az elektromos mezőt, így a hagyományos, kamrába épített detektorok hatékonysága nagyságrenddel csökken. Erre a problémára a megoldást az oszlopban elhelyezett, úgynevezett in-lens rendszerű detektorok jelentették, melyek ebben az elektronoptikai konfigurációban nagy hatékonysággal gyűjtik a visszaszórt és különösen a szekunder elektronokat.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6679021/#:~:text=The%20in%2Dlens%20detector%20is,high%20collection%20efficiency%20%5B2%5D.>

https://www.researchgate.net/publication/51240846_A_Comparison_of_Conventional_Everhart-Thornley_Style_and_In-Lens_Secondary_Electron_Detectors-A_Further_Variable_in_Scanning_Electron_Microscopy

81. A 8. kezdeményezési elem a „Szoftverből vezérelhetően betolható-kihúzható szilárdtest detektor visszaszórt elektronokhoz, koncentrikus gyűrű alakú szegmensekkel” előírással kapcsolatban előadta, hogy a vizsgált minta anyagszerkezeti jellemzőinek feltárásához szükség van a visszaszórt elektron jelek differenciálására kilépési szög vagy kilépési irány szerint. Ezt a funkciót a többszegmenses visszaszórt elektrondetektor nyújtja, ahol a fizikailag független, gyűrű alakú szegmensek biztosítják a kilépési szög szerinti differenciálást. Ezt a megoldást az ajánlatkérő nem látja más módon (akár egyenértékű módon) biztosítotttnak, így az előírása nem jogsértő.

82. A 9 kezdeményezési elem az „Infravörös megvilágítású, élőképet adó CCD kamera a kamrában, mely a szekunder elektron képalkotással egyidőben is használható visszaszórt elektron detektor használatkor az infravörös megvilágítás automatikusan lekapcsol” előírás kapcsán közölte, hogy a minta kamra megfigyelését biztosító kamera szintén moduláris

egysége a mikroszkópnak. A CCD kamerák a mikroszkópok részegységét képezik, de a mikroszkóp gyártók jellemzően nem fejlesztenek saját kamera egységet, hanem harmadik fél késztermékét építik be/fejlesztik berendezéseikbe. Ezáltal a mikroszkóp gyártók jelen elvárás egy megfelelő tulajdonságú moduláris rész megajánlásával teljesíteni tudják. Azt bármelyik gyártó képes saját rendszerébe integrálni és az automatikus lekapcsolást a szükséges elektronikával megoldani. Lásd például <https://deben.co.uk/e-beam-instrumentation/sem-chamberscope/>

83. Ismertette továbbá, hogy az infravörös megvilágítású, élőképet adó CCD kamera a kamrában fontos biztonsági tartozék, mellyel elkerülhetővé válik a minta, objektív pólus, betolható detektorok nem kívánatos ütközése. Ez gyártótól függetlenül szinte az összes pásztázó elektronmikroszkóp típus sztenderd tartozéka vagy rendelhető tartozéka, akár a gyártótól, akár harmadik féltől.

84. Utalt arra, hogy a kamerához tartozó infravörös megvilágítás azonban telíti a visszaszórt elektron detektorokat, azokkal egyszerre nem használható. Nem indokolatlan elvárás, hogy a visszaszórt elektron detektor használatakor a kamera infravörös megvilágítása kapcsoljon le. Ezt a megfelelő hardver és szoftver interfésszel bármely gyártónak lehetősége van megvalósítani, így ez nem jogsértő előírás.

85. A 10. kezdeményezési elem a „A mikrotóm kezelő funkciói legyenek a mikroszkóp szoftveres felhasználói felületébe integráltak” követelmény kapcsán előadta, hogy a Serial Block Face Imaging nagy szakértelmet és odafigyelést igénylő munka az operátor részéről. A minta rögzítését követően a kezelő megkeresi a leképezni kívánt területet vagy területeket, felprogramozza a szeleteléshez szükséges paramétereket és elvégzi a beközelítést (approach), mely meghatározza a mikrotóm kés finompozícióját a szeletelés indításához. Ezekhez, valamint a szeletelés és leképezés indításához a felhasználói felületen folyamatosan és egyidejűleg felügyelni kell az elektronmikroszkóp paramétereit, az elektronmikroszkópos képet és a mikrotóm beállításait és pillanatnyi állapotát. Egy esetleges hiba költséges következményekkel jár, az előkészített minta és a gyémántkés is könnyen károsodhat. Ezért fontos, hogy a teljes folyamat egy erre a célra optimalizált, egységes felhasználói felületről legyen irányítható.

86. Összegezve előadta, hogy valamennyi kezdeményezési elem tekintetében kéri jogsértés hiányának a megállapítását, mivel az előírásai nem sértik a kezdeményező által ismertett rendelkezéseket, azaz nem versenykorlátozóak.

Az érdekelt észrevétele

87. Az érdekelt észrevételében közölte, hogy az SBFI (Serial Block Face Imaging) pásztázó elektronmikroszkópia kis mintákról, nagy felbontású háromdimenziós képek előállítására szolgáló, Magyarországon is jól ismert módszer, több ilyen eszközt telepítettek az elmúlt évek során pl. Debrecenben (DE Anatómiai Intézet) és Budapesten (KOKI). A technikát agyszövet vizsgálatára fejlesztették ki, de széles körben alkalmazható bármilyen biológiai mintára. Az SBFI pásztázó elektronmikroszkóp egy ultramikrotóm - metsző berendezésből áll, amelyet a pásztázó elektronmikroszkóp vákuumkamrájába telepítenek. A mintákat a hagyományos transzmissziós elektronmikroszkópiához (TEM) hasonló módszerekkel készítik elő: a mintát aldehyddel rögzítik, nehézfémekkel, például ozmiummal és uránnal festik, majd epoxigyantába ágyazzák, ellentétben a krio-mikroszkópiával, ahol a mintákat natív állapotban, gyorsfagyasztással készítik elő. Kifejtette, hogy a gyantába

ágyazott minta blokkjának felületét visszaszórt elektronok detektálásával képezik le, majd az ultramikrotómmal vékony (20-30 nm) metszetet vágnak le a blokk felületéről. A metszet levágása után a mintablokkot visszaemeli a fókuszsíkra, és újra leképezi a rendszer. Ez a mintaképkalkotás, metszetvágás és blokk emelés sorozat több ezer képet készíthet tökéletes igazításban, automatizált módon.

88. Az érdekelt hangsúlyozta, hogy mind műszaki, mind gazdasági értelemben a maximumot kívánja nyújtani minden tudományos projekthez. Célja, hogy a felhasználók széleskörű tájékoztatást kapjanak választásuk megtételéhez, több információhoz juthassanak a műszaki megoldásokról és módszerekről, különösen egy közel 3 milliárd forintos költségvetéssel rendelkező projekt esetén.

89. Kifejtette, hogy a közbeszerzési eljárás során igyekezett párbeszédet nyitni több kötelező, az elektronmikroszkópokkal kapcsolatos, ajánlatkérő specifikus műszaki igényéről.

90. Kiemelte annak tényét, hogy az ajánlatkérő által a észrevételeben szereplő, illetve vonatkozó műszaki tartalom csak néhány esetben vonatkozik az érdekelt pásztázó elektronmikroszkópokra.

91. Az ajánlatkérő észrevételeire előadta, hogy elektronmikroszkópokra vonatkozó, kötelezően teljesítendő műszaki tartalma egyetlen gyártó elektronmikroszkópjait részesíti előnyben, melyet mind a jelen közbeszerzésben küldött, mind a 2022-ben indított közbeszerzésben vitarendezésében is kifogásolt, illetve amit az 1. részben megtett megjegyzéseiben is jelezte.

92. Kifejtette, hogy az ajánlatkérő által elfogadhatónak leírt, egyedi fejlesztéssel megvalósított, a piacon jelenleg nem létező megoldás megajánlása több akadályba is ütközik. Ismertette, hogy jól átgondolt, saját fejlesztési koncepció alapján kialakított műszaki megoldásában az egyes elemek összefüggenek egymással. Más gyártó termékét másoló megoldás műszakilag észszerűtlen, gazdasági értelemben is aránytalanul nagy terhet róna az érdekeltre. Utalt arra, hogy felelős üzletpolitikája az olyan szállításokat támogatja, melyek 100%-osan kidolgozott, befejezett koncepciókra/eszközökre vonatkoznak.

93. Egyetértett az ajánlatkérő azon véleményével, mely a nagy vákuumban a nagy felbontású, alacsony gyorsítófeszültséggel végzett képkalkotás kivételes lehetőségeit sorolja fel érzékeny (pl. biológiai) minták esetén. Amennyiben az elektronmikroszkóp alkalmas erre a vizsgálati módra, a SBFI minták legnagyobb része rendkívül jó eredménnyel vizsgálható. Egyúttal az ajánlatkérő felsorolta azokat a további gyártókat (pl. JEOL, Zeiss), amelyek ajánlatot tehettek volna, ha a műszaki specifikáció nem csak egy cégre vonatkozik.

94. A 3. kezdeményezési elemmel a „Kisvákuum nyomástartomány 0-500 Pa vagy bővebb” összefüggésben tett ajánlatkérői észrevételre az érdekelt előadta, hogy a képminőséget jelentősen befolyásoló töltődés jelensége a besugározó elektronok a minta felületén történő felhalmozódásából ered. A töltődés kiküszöbölése téremissziós (F SEM), vagy a változtatható nyomáson üzemelő pásztázó elektronmikroszkóp (LV SEM) használatával oldható meg.

95. Hangsúlyozta, hogy az alacsony vákuumban a 100 Pa feletti nyomás azonban kontraproduktív a Serial Block Face (SBF) képkalkotásnál. A legjobb eredmény alacsonyabb nyomásnál érhető el, mivel 100 Pa felett az elektronnyaláb szóródik a mintatérben található

gázmolekulákon, fókuszálása nem olyan jó, mint nagyvákuum módban. A primer elektronsugár és a kamrában lévő molekulák rugalmatlan ütközése jelentős felbontásvesztéssel jár.

96. Ismertette továbbá, hogy az F SEM-ben nagyvákuumban kis gyorsítófeszültség alkalmazása esetén a felbontási értékek jobbak, ezzel részletgazdagabb eredmény érhető el. Korábban ez a technika több gyártónál nem volt kielégítő, többnyire ezért alkalmaztak alacsony vákuumot. Alacsony vákuum mód használata esetén 30-60 Pa nyomásérték elegendő a töltődés kiküszöbölésére, azonban kompromisszumot kell kötni a felbontás rovására.

(forrás: Protokollok kidolgozása a csontszövet első block face pásztázó elektronmikroszkópos (SBF SEM) vizsgálatához
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S8756328219304004> 2.2.3. Optimisation of SBF SEM imaging conditions)

97. Az 5. kezdeményezési elem kapcsán utalt a bemutatott SBFI módszerre, ahol a gyantába ágyazott mintablokkból a FEG SEM mintakamrába telepített ultramikrotómmal sorozat metszeteket metsz, illetve a metszés közben felvett képeket 3D szoftverrel rekonstruálja. Kiemelte, hogy mind az ultramikrotóm, mind a minta rögzített helyzetben van a metszés során, nincs megdöntve.

98. A 6. kezdeményezési elemmel összefüggésben tett észrevételre közölte, hogy a mechanikusan eucentrikus mintaasztalt úgy alakította ki, hogy nem veszíti el a fókuszbeállításokat, még akkor sem, ha a mintát megdöntik, vagy a tárgyasztal magasságát változtatják a mozgató tartományon belül. A mechanikusan eucentrikus nem azonos az analitikai pozíción eucentrikus mintaasztallal, melynél a mintaasztal analitikai pozícióban (ez legtöbbször 10mm) döntés esetén megtartja a fókuszbeállításokat. A link helyesen mutatja, hogy a mechanikusan eucentrikus funkciót csak az érdekelt elektronmikroszkópjai tudják biztosítani.

99. Fentieket összefoglalva, az érdekelt előadta, hogy mind technológiai, mind szakmai, mind gazdasági háttére szempontjából alkalmas és megfelelő eszközökkel rendelkezik kriomikroszkópiás, analitikai transzmissziós és SBFI pásztázó elektronmikroszkópos eszközök szállítására.

A Döntőbizottság döntése és annak indokai

100. A jogorvoslat alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás 2024. március 7-én indult, ezért a Döntőbizottság az ezen időpontban hatályos rendelkezések alapján bírálta el a kezdeményezést érdemben, míg a jogorvoslati eljárásra eljárásjogi szempontból a kezdeményezés benyújtása napján 2024. október 15. napján hatályos Kbt. rendelkezései az irányadóak.

101. A Döntőbizottság az érdemi vizsgálatot az alábbi rendelkezések alapján folytatta le.

A Kbt. 2. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági szereplők számára és arányos módon kell eljárnia a közbeszerzési eljárás során.

A Kbt. 58. § (1)-(4) bekezdései az alábbiakat ismerteti:

„(1) Az ajánlatkérő köteles megadni a közbeszerzés tárgyát és mennyiségét - adott esetben opcionális rész megadásával - az eljárást megindító felhívásban, valamint előzetes tájékoztatóval meghirdetett eljárás esetén az előzetes tájékoztatóban is.

(2) Az ajánlatkérő köteles megadni az eljárást megindító felhívásban vagy a további közbeszerzési dokumentumokban a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást. A műszaki leírás azoknak az előírásoknak az összessége, amelyek meghatározzák azokat a közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzőket, amelyek alapján a közbeszerzés tárgya olyan módon írható le, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek. E jellemzők utalhatnak a kért építési beruházás, áru vagy szolgáltatás előállításának és nyújtásának folyamatára vagy módszerére, vagy életciklusa bármely más szakaszának valamely konkrét folyamatára, akkor is, ha ezek a tényezők végeredményben nem befolyásolják az adott építési beruházás, áru vagy szolgáltatás tulajdonságait, feltéve, hogy kapcsolódnak a szerződés tárgyához [76. § (7) bekezdés], valamint annak értékéhez és céljaihoz képest arányosak.

(3) A műszaki leírásnak valamennyi gazdasági szereplő számára egyenlő hozzáférést kell lehetővé tennie, és nem lehet olyan hatása, amely indokolatlanul akadályozná a verseny biztosítását a közbeszerzés során.

(4) A műszaki leírás meghatározására és tartalmára vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg.”

A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles megvizsgálni, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Ha az ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt, az eljárást megindító felhívásban köteles megadni ennek indokát.

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 46. § (2)-(5) bekezdései szerint:

„(2) A közbeszerzési műszaki leírást - az Európai Unió jogával összeegyeztethető kötelező műszaki szabályok sérelme nélkül - az ajánlatkérő választása szerint a következő módok valamelyikén kell meghatározni:

a) teljesítmény-, illetve funkcionális követelmények megadásával, ideértve a környezetvédelmi jellemzőket is,

b) építési beruházási munkák tervezése, számítása és kivitelezése, valamint a termék alkalmazása tekintetében az európai szabványokat, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat, az európai szabványügyi szervezetek által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványokra, vagy ezek hiányában nemzeti szabványokra, nemzeti műszaki engedélyre, illetve nemzeti műszaki előírásokra történő hivatkozással; vagy

c) az a) pont szerinti követelmények alapján, az e követelményeknek való megfelelés vélelmét biztosító, a b) pontban meghatározottakra történő hivatkozással; vagy

d) egyes jellemzők tekintetében a b) pontban meghatározottakra, más jellemzők tekintetében pedig az a) pontban meghatározott követelményekre történő hivatkozással.

(3) A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kizorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának (2) bekezdés

szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.

(4) A (2) bekezdés a) pontjára való hivatkozás esetén a követelményeket úgy kell meghatározni, hogy ezek kellően pontosak legyenek ahhoz, hogy lehetővé tegyék az ajánlattevők számára a szerződés tárgyának megállapítását, az ajánlatkérők számára pedig a szerződés odaítélését. Az említett pontra való hivatkozás esetén nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.

(5) A (2) bekezdés b) pontja esetén az ajánlatkérő köteles a szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szerepeltetni. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő építési beruházások, termékek vagy szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásnak, ha az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.”

A Kbt. 76. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles az eljárást megindító felhívásban meghatározni azt a szempontot vagy szempontokat, amelyek alapján a számára – az adott esetben szociális, társadalmi és környezetvédelmi szempontból is – gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot kiválasztja (a továbbiakban: értékelési szempontok).

A Kbt. 76. § (6) bekezdés ismerteti, hogy az értékelési szempontoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

- a) a szerződés tárgyához kell kapcsolódniuk;
- b) nem biztosíthatnak önkényes döntési lehetőséget az ajánlatkérőnek, hanem mennyiségi vagy szakmai szempontok alapján értékelhető tényezőkön kell alapulniuk;
- c) biztosítaniuk kell a 2. § (1)–(5) bekezdésében foglalt alapelvek betartását;
- d) az értékelési szempontok körében nem értékelhető az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassága. A (3) bekezdés b) pontjában foglaltak értékelése esetén, ha az eljárásban e körülményekhez alkalmassági feltétel is kapcsolódik, egyértelműen el kell különíteni, hogy mely feltételek képezik a teljesítéshez minimálisan szükséges elvárást (alkalmassági követelmény), és melyek jelentik ezen felül az értékeléskor figyelembe vett tényezőket;
- e) nem eredményezhetik ugyanazon ajánlati tartalmi elem többszöri értékelését.

A Kb. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást vagy költséget tartalmazó értékelési szemponton kívüli értékelési szempontokkal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban az eljárást megindító felhívásban jogosult meghatározni az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési pontszám felső határával azonos számú pontot ad. Az ajánlatkérő bármely szempont tekintetében, valamint – az átalánydíjas szerződések kivételével – az önállóan nem értékelt, de az ajánlattevő ajánlatában foglalt, az ajánlatkérő által a szerződés alapján fizetendő ellenszolgáltatást rögzítő egységár vagy költség tekintetében, jogosult meghatározni olyan elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet.

102. A Döntőbizottság az 1. kezdeményezési elem vizsgálata során megállapította, hogy a kezdeményező annak megállapítását kérte, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 76. § (6) bekezdés c) pontját, a Kbt. 77. § (1) bekezdését, a Kbt. 2. § (2) bekezdését és a Kbt. 58. (2)-(3) bekezdését a „Pásztázó elektronmikroszkóp SBFi technikához műszaki paramétere - Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 3 kV-on – (2,7-1,8 nm)” és „Pásztázó elektronmikroszkóp SBFi technikához műszaki paramétere - Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 15 kV-on – (1,8-1,2 nm)” minőségi értékelési szempontra vonatkozó értékelési előírások és érvénytelenségi ok jogsértő meghatározásával. A kezdeményező szerint megállapítható, hogy egyik gyártó a Tescan Group a.s. pásztázó elektronmikroszkópjának értéke 2,7 nm feletti (3 nm), így az egyébként szakmai szempontból megfelelően működő pásztázó elektronmikroszkópjával a közbeszerzési versenyben nem vehet részt. Rámutatott arra is, hogy a Tescan Group a.s. pásztázó elektronmikroszkópja számos műszaki jellemzőjét méri, de a „Felbontás szekunder elektronokkal kisvákuumban 15 kV-on” tekintetében gyártói adat nem áll rendelkezésre, mivel a gyártó nagyvákuumban 30 kV-on méri az értékét, és akkor a felbontás 1.8 nm.

103. A Kbt. 76. § (6) bekezdés c) pontja azt az előírást tartalmazza, hogy az ajánlatkérőnek olyan értékelési szempontot kell megjelölnie, mely biztosítja az alapelvek betartását.

104. Fontos annak kiemelése, mely több bírósági döntésben is rögzítésre került, hogy „... nem minősíthető az előírás pusztán azért versenykorlátozónak és ez által jogsértőnek, mert azt a beavatkozó nem tudja teljesíteni. (...) Az ajánlatkérőnek van beszerzési igénye, ő tudja, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkező eszközökre van szüksége. Az elvárásait a saját igénye szerint kell megfogalmaznia, a versenyben indulóknak pedig ezeknek megfelelő ajánlatot kell tenniük. Minden alapot nélkülöz ezért az az ítéleti megállapítás, miszerint az alperesnek vizsgálnia kellett volna a piac összetételét, és elemeznie kellett volna, hogy az adott lélegeztetőgép-típust mennyi és mely piaci szereplő tudná szolgáltatni. A verseny korlátozásának jogszerűsége nem azon múlik, hogy van-e olyan gazdasági társaság, amely a felhívásban rögzített paramétereknek megfelelő eszközt képes ajánlani, hanem azon, hogy indokolt-e az adott feltétel előírása, az illeszkedik-e a beszerzés tárgyához, az elvárt követelmény, funkció feltétlenül szükséges-e.” (Kfv.III.37.206/2021/6.)

105. A Döntőbizottság megvizsgálta az ajánlatkérő és az érdekelt által előadott szakmai indokokat, hiszen ezen szakmai indokok alapján kell a Döntőbizottságnak azt eldöntenie, hogy indokolt-e az előírás meghatározása, mivel a kezdeményező szakmai érveket nem ismertetett. Az ajánlatkérő ismertette, hogy célja a világviszonylatban vezető kutatási potenciállal rendelkező „Core Facility”-khez, tudományos kutatólaboratóriumokhoz való csatlakozás. Az egyetemi színvonalú kutatáshoz, és a nemzetközi élenjáró kutatási programokban való részvételhez az ezen műszaki leírásaiban meghatározott berendezések, és az azokból összeállított egységes rendszer beszerzése szükséges.

106. Kiemelte, hogy nem írt elő olyan követelményt, hogy csak jelenleg forgalomban lévő eszközök, részegységek szállítását fogadja el. Az ajánlatkérő beszerzési igényének teljesítése - piackutatása alapján - egyes esetekben megkövetelheti a forgalomban lévő, „katalógusban szereplő” eszközök átalakítását, és/vagy moduláris bővítését, amelyekre több műszaki követelmény tekintetében is utalt.

107. Hangsúlyozta, hogy a tudományterület, valamint az azt kiszolgáló ipar sajátossága, hogy az elérhető termékek „kísérleti jellegűek”, sokszor prototípusoknak tekinthetők, rövid

termékciklusokkal, folyamatos fejlesztésekkel. Ebből következik a piac azon sajátossága, hogy sok esetben egy adott időpontban elérhető terméktípus beérkezett megrendelés alapján történő legyártása a katalógusban szereplő paraméterekhez képest adott esetben már fejlettebb megoldásokkal, jobb potenciális képességekkel fog megtörténni. A megajánlható termékek, rendszer esetében nem tett olyan korlátozást, mely szerint azok, a rendszer egyes részegységei csak egyetlen gyártótól származhatnak.

108. Kifejtette továbbá, hogy a beszerzési igény tervezése során figyelembe vette, hogy a tervezett kutatási projektek ki fognak terjedni a sejtkutatástól kezdve a mikroműanyagok és nanoanyagok élettani hatásaira is, mely különösen speciális műszerezettséget igényel. Az ártalmas anyagok bejutását és eloszlását a biológiai szervezetben a sejtszintű méretskálától kezdve lehet majd vizsgálni. Innen a sejtalkotók szintjén át lehetséges az eljutás az egyes fehérjék térbeli szerkezetére gyakorolt hatásokig. A teljes folyamat leképezése és megértése funkcionális kapcsolatot igényel a leendő laboratórium eszközei között.

109. A vitatott paraméterek alapján közölte, hogy a megcélzott kutatások interdiszciplináris jellege megköveteli, hogy a berendezés a rendelkezésre álló paraméterter jelentős részén kiemelkedő képalkotással rendelkezzen, hogy a korszerű elektronoptika alacsony és magas gyorsítófeszültségek mellett egyaránt biztosítsa a technikailag elérhető legjobb felbontást. Biológia minták, vékonyrétegek, könnyűelemes vagy érzékeny felületű anyagtudományi minták vizsgálata esetén különösen fontos a jó felbontású alacsony energiás képalkotás, mivel alacsony energián láthatóvá válnak olyan felszíni jellegzetességek, melyek nagy gyorsítófeszültséggel nem leképezhetők. Ezen túl az alacsony energia kevésbé roncsolja a kutatásban szerepet kapó, jellemzően érzékeny biológiai mintákat.

110. Vitatta azon álláspontot, hogy a 3 nm értékű felbontás és a 2,7 nm felbontás között érdemi különbség nincs. Az ajánlatkérő ezzel nem értett egyet, annak okán sem, hogy a piacon több olyan mikroszkóp is elérhető, melynek felbontása az előírtnál lényegesen magasabb, így sokkal jobb minőségű képalkotás is elérhető. Utalt arra, hogy nem célja, és nem is kötelessége a legkisebb tudású eszközökhöz igazítani a beszerzési igényét.

111. Példaként említette a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatásait, ahol az idegtudományi kutatásokban szerepet kapó block face pásztázó elektronmikroszkópon folyó képalkotási munka szinte kizárólag az 1-3 kV között, alacsony gyorsítófeszültségen zajlott.

112. A Döntőbizottság elfogadva az ajánlatkérő álláspontját rögzíti, hogy a nyilvánosan elérhető adatbázisokból megállapítható, hogy a csúcskategóriás pásztázó elektronmikroszkópok (SEM) 3 kV-on kisvákuumban 1 nm körüli értékűek, melyek a szakirodalom szerint leginkább kutatási célból alkalmazandóak, hiszen az SBFi technikához, mely a mintafelület szekvenciális letapogatásával és metszésével dolgozik, különösen fontos a nagy felbontás, hogy a minták finom szerkezeti részletei jól megjelenjenek. Az érzékeny biológiai és vékonyréteg-minták esetében az alacsony energiás (1-5 kV) üzemmódra optimalizált elektronoptikai rendszer elengedhetetlen, ami a csúcskategóriás SEM-eknél (pl. Thermo Fisher Helios, Zeiss GeminiSEM) az alacsony energián elérhető felbontás akár 1-3 nm lehet megfelelő körülmények között, ahol a gyorsítófeszültség-tartomány (pl. 0,1–30 kV) lefedése szükséges, hogy mind az alacsony energiás finom felületi képalkotást, mind a nagy energiás mélyebb penetrációt (pl. EDS/EBSD alkalmazásokhoz) támogassa.

113. Vitatva a kezdeményező által előadottakat az is megállapítható, hogy a vezetők pásztázó elektronmikroszkóp-gyártók rendszerint végeznek részletes méréseket különböző

gyorsítófeszültségeken (pl. 15 kV, 3 kV stb.) a mikroszkópjaik teljesítményének meghatározására. A gyártók jellemzően különböző gyorsítófeszültségeken, például 15 kV-on és 3 kV-on is megadják a mikroszkópok elérhető felbontását, hiszen ezek a leggyakoribb feszültségek, amelyeket a kutatók használnak. Az alacsony feszültségen (pl. 3 kV) mért felbontás kulcsfontosságú az érzékeny minták (pl. biológiai minták, vékonyrétegek) vizsgálata során. A nem vezetőanyag minták esetében 3 kV körüli gyorsítófeszültségen végzett mérések mutatják meg a minta töltődési hajlamát és a kisvákuumos üzemmód hatékonyságát.

A gyártók így például a Zeiss, Thermo Fisher, Hitachi, TESCAN, JEOL stb. rendszeresen publikálnak méréseket és műszaki dokumentációkat, amelyek részletezik a berendezéseik képességeit különböző gyorsítófeszültségeken. Vitatható a kezdeményező hivatkozása a TESCAN termékeinek hiányára, hiszen a MIRA és VEGA sorozat specifikációiban a felbontás 3 kV-on és 15 kV-on is szerepel.

114. Összegezve a fentieket a Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő a fenti gyorsítófeszültségen elvárt alacsony felbontási értékek indokoltak és szükségesek az ajánlatkérő által ismertetett kutatás elvégzéséhez, így a kezdeményezés ezen eleme nem indokolt.

115. A Döntőbizottság ezt követően a kezdeményező 2. kezdeményezési elemét vizsgálta, melyben a kezdeményező a „Kölcsönhatási energia tartomány (fokozatmentesen változtatható a tartományon belül) legalább 20 eV-30 000 eV vagy bővebb – melynél a minimum érték a 20 eV” műszaki paraméter kapcsán állította annak indokoltsága és arányossága hiányát.

116. Az ajánlatkérő kifejtette, hogy a legutóbbi évtizedben kerültek előtérbe azok a kutatási irányok, melyek kimondottan alacsony kölcsönhatási energiás leképezést igényelnek, a 10...50 eV tartományban. Ilyenek az ultravékony rétegek, 2D anyagok pl. grafén, bizonyos polimerek, ezen túl a felszíni potenciál leképezését igénylő feladatok. Extrém alacsony kölcsönhatási energia tartományban láthatóvá válnak olyan felületi jellemzők, amelyek nagyobb gyorsítófeszültséget használva korábban nem voltak megfigyelhetők, például a vizsgálandó struktúra vékonysága miatt.

117. Hangsúlyozta, hogy ennek a követelménynek több ismert mikroszkóp típus is eleget tesz, így az nem versenykorlátozó, hanem a kutatási igények kifejezője. Példaképpen a Jeol 10 eV kölcsönhatási energián készült képet tette közzé:

<https://www.jeolusa.com/RESOURCES/Electron-Optics/Documents-Downloads/extreme-low-voltage-imaging>

118. Utalt arra, hogy a kezdeményező nem adta meg, hogy álláspontja szerinti milyen tartományt, értéket tartana megfelelőnek, indokoltnak, ezért álláspontja szerint a kezdeményezés nem megalapozott.

119. A Döntőbizottság megállapította, hogy a pásztázó elektronmikroszkópok esetében a minimum 20 eV kölcsönhatási energia általában elterjedt normának tekinthető, mivel ez a szint elegendő ahhoz, hogy a szórt elektronok jelentős információt adjanak a mintáról. A kölcsönhatási energia meghatározza, hogy az elektronok mennyire képesek kölcsönhatásba lépni a minta atomjaival, ami kulcsfontosságú a képalkotás és a spektrális elemzés szempontjából. A 20 eV körüli energiaszint biztosítja, hogy a szórt elektronok elegendő információt gyűjtsenek, és elkerüljék a minta túlzott károsodását, ami különösen fontos lágy anyagok vagy bioanyagok esetén.

A Döntőbizottság döntésekor az alábbi forrásokat használta:

Goldstein, J. I., et al. „Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis.”
Reimer, L. „Scanning Electron Microscopy.”
Hawkes, P. W., & Kasper, E. „Principles of Electron Optics.”

120. A fentiek alapján a Döntőbizottság az ajánlatkérő álláspontjával egyetértve az előírás szükségességét és indokoltságát állapította meg, ezért e körben a kezdeményezés nem alapos.

121. A Döntőbizottság ezt követően a 3. kezdeményezési elemet vizsgálta, melyben a kezdeményező annak megállapítását kérte, hogy a „Kisvákuum nyomástartomány 0-500 Pa vagy bővebb, melynél a minimum érték 0 Pa” előírás nem teljesíthető, indokolatlan és aránytalan.

122. A Döntőbizottság elfogadta az ajánlatkérő azon hivatkozását, mely szerint nem volt előírás az adott műszaki tulajdonság vonatkozásában 0 Pa minimumértéket, mivel 10 -500 Pa került rögzítésre.

123. Az ajánlatkérő hangsúlyozta, hogy a kamra megfelelő nyomástartománya fontos felhasználói szempont, hiszen a vizsgálandó gyantába ágyazott anyagok esetleges elektrosztatikus töltődése nem kívánt torzítást okoz. Hasonló a helyzet a különböző, fémesen nem vezető kompozit anyagokkal, melyek egyszerre igényelnek alacsony gyorsítófeszültséget és viszonylag magas kamranyomást. A megkövetelt 500 Pa nyomás nem szélsőséges érték, a nyilvánosan elérhető műszaki információk szerint azt több gyártó is teljesíti vagy akár túlteljesíti. Például a Tescan Vega 3 típusal akár 2000 Pa kamranyomás is elérhető, így ezen tulajdonság megléte az ajánlatkérő által beszerezni kíván csúcstechnológiás kutató eszköz felhasználhatóságához szükséges, ezért indokolt elvárás.

124. A Döntőbizottság elfogadta az ajánlatkérő álláspontját és megállapította, hogy a kisvákuum a pásztázó elektronmikroszkópok (SEM) esetében a vákuumszint lehetővé teszi nem vezető minták vizsgálatát vezetőréteg nélkül, és megakadályozza a minták feltöltődését a nyalábhatás miatt. A kutatási területtől függ a megfelelő nyomástartomány, továbbá találhatóak olyan pásztázó elektronmikroszkópok amelyek akár 10 Pa alatti és olyanok is amelyek 500 Pa feletti nyomás is elérhető, ezért a Döntőbizottság a kezdeményező ezen elemét nem találta alaposnak, különösen azért sem, mivel téves értéket vitatott a tényleges érték helyett.

125. A Döntőbizottság megállapította, hogy az érdekelte a nyomás felső határa kapcsán adta elő szakmai álláspontját vitatva annak megfelelőségét. Fontos annak kiemelése, hogy a Döntőbizottságnak a kezdeményezés alapján kell vizsgálni az ajánlatkérői előírások megfelelőségét, és a kezdeményező a minimum érték megfelelőségét és teljesíthetőségét vitatta az érdekelttel ellentétben, így az érdekelte álláspontja jelen kezdeményezés kapcsán indifferens.

126. A Döntőbizottság ezt követően a 4. kezdeményezési elemet vizsgálta, melyben a kezdeményező annak megállapítását kérte, hogy az „akkumulátoros védelem az iongetter tápegységben” előírás kapcsán más egyenértékű módon is biztosítható az akkumulátor védelme, mint az iongetter tápegységben például védelmi lekapcsolási funkcióval, emiatt jogsértő a követelmény.

127. Az ajánlatkérő kifejtette, hogy a műszaki leírásban előírt követelmény nem az akkumulátor védelmét biztosítja, hanem áramszünet esetén az iongetter szivattyúk működését

tartja fenn akkumulátorokkal, a vákuumrendszer védelme érdekében. Ennek hiányában egy esetleges áramszünet az iongetter szivattyúk leállításával jár. A készülék ezt követően hamarosan elveszti az ultranagy vákuumot. Azonnali beavatkozás hiányában - ez csak a szerviz beavatkozásával, a vákuumrendszer kondicionálásával hozható rendbe. Ez extra költséget és feleslegesen kieső napokat jelent. Az iongetter tápegységek akkumulátoros védelme egy akár 8 órás áramszünetet is képes áthidalni az ultranagy vákuum összeomlása nélkül.

128. Hangsúlyozta, hogy az említett „védelmi lekapcsolási funkció” csak korlátozott védelmet nyújt, ez áramszünet esetén is képes „szabályosan” leállítani a berendezést, de a vákuumállapotot nem tartja fenn.

129. A Döntőbizottság az ajánlatkérő érveit elfogadva tudományos szakirodalomból megállapította, hogy „A pásztázó elektronmikroszkópok (SEM) esetében az iongetter tápegység védelme általánosan elterjedt, mivel az ilyen típusú mikroszkópok működéséhez elengedhetetlen a vákuum fenntartása. Az iongetter tápegységek segítenek a vákuum elérésében és fenntartásában, valamint a szennyeződések és gázok eltávolításában, amelyek zavarhatják a képalkotási folyamatokat.

Vákuum fenntartása: Az iongetter tápegységek védelme kulcsszerepet játszik a vákuum stabilitásának megőrzésében, ami elengedhetetlen a SEM megbízható működéséhez.”

A Döntőbizottság döntése meghozatalakor az alábbi forrásokat használta:

W. Paul et al., „Scanning Electron Microscopy: Physics of Image Formation and Microanalysis”

T. E. H. Allsop, „Electron Microscopy: Principles and Techniques in Materials Science” - K. B. T. Egerton, „Electron Energy-Loss Spectroscopy in the Electron Microscope”

130. A Döntőbizottság ezt követően az 5. kezdeményezési elemet vizsgálta, melyben a kezdeményező a „Mintaasztal döntési tartománya -5 °- + 90 ° vagy bővebb” előírást vitatta, mivel ettől kis mértékben eltérő, de egyenértékű módon is biztosítható a mintaasztal döntési tartománya.

131. Az ajánlatkérő ismertette, hogy a tervezett vizsgálati eljárások során szükséges a minták teljes, minden irányból történő vizsgálhatósága, keresztmetszeti felületek leképezése, mely a megjelölt forgatási intervallum mellett lehetséges. Példaként említette, hogy a vékony minta keresztmetszeti vizsgálatához kifejezetten 90 fokos mintadöntés szükséges. Ez egy csúcstechnológiás kutató eszköz esetében indokolt elvárás. A megkövetelt döntési tartomány a nyilvánosan elérhető műszaki információk szerint nem szélsőséges érték, azt több gyártó is teljesíti, például a Tescan Mira 3 XM.

132. A mintaasztal döntési tartományait tehát az SEM típusának és az adott minta vizsgálati szükségleteinek megfelelően választják meg, hogy optimális megfigyeléseket és képeket érhessenek el a kívánt felbontásban

133. A Döntőbizottság elfogadva az ajánlatkérő érveit hangsúlyozza, hogy az ajánlatkérő nem egy általános cél eléréséhez alkalmazandó berendezés műszaki paramétereit ismertette, hanem a specifikus alkalmazások teszik szükségessé ezeket a paramétereket, melyek indokoltsága és szükségessége szakmai alapon indokolt, ezért ezen előírás jogszerű.

134. A Döntőbizottság ezt követően a kezdeményező 6. kezdeményezési elemét vizsgálta, melyben a kezdeményező a „Mintaasztal analitikai munkatávolságon legyen mechanikusan

eucentrikus” előírás kapcsán állította, hogy más egyenértékű módon is biztosítható megfelelő mintaasztal például computer vezérelt eucentrikus asztal, emiatt indokoltsága és arányossága nem állapítható meg.

135. Az ajánlatkérő kifejtette, hogy az eucentrikus tulajdonság azt jelenti, hogy a mintaasztal döntése közben a mintán megfigyelt terület nem mozdul el, nem csúszik ki a képből. Ez elérhető mind a mintaasztal mechanikus felépítése révén, mind számítógépes korrekcióval („computer vezérelt eucentrikus asztal”). A két megoldás nem egyenértékű. Mechanikusan eucentrikus mintaasztal esetén a mintapozíció beállítható úgy, hogy döntési tengely pont a vizsgált területen haladjon át, ez biztosítja, hogy a vizsgált terület mindig a képen maradjon. Computer vezérelt eucentrikus asztal esetén a számítógép a döntés függvényében korrigál az X és Y tengelyek mozgásával, ennek pontossága korlátozott, a mozgás szaggatott.

136. Ismertette, hogy ezt a követelményt egyébiránt sok gyártó több ismert típusa teljesíti, így egyáltalán nem indokolatlanul versenykorlátozó az előírás.

<https://www.jeol.com/products/scientific/sem/JSM-7610FPlus.php>

137. A Döntőbizottság elfogadta az ajánlatkérő azon érvelését, mely szerint a vizsgált terület helyzete döntés közben kritikus fontosságú számára, ezért a mechanikusan eucentrikus asztal indokolt és szükségszerű, így a kezdeményező ezen kezdeményezése nem alapos.

138. A Döntőbizottság ezt követően a kezdeményező 7. kezdeményezési elemét vizsgálta, melyben a kezdeményező In-lens rendszerű szegmentált visszaszórt elektron detektor” előírást vitatta, mivel más egyenértékű módon is biztosítható megfelelő detektor így például szcintillációs detektorral, emiatt ezen előírás nem indokolt és arányos.

139. Az ajánlatkérő szerint az in-lens rendszerű detektorok nem válthatók ki nem in-lens, azaz kamrába szerelt detektorral. A megnevezett szcintillációs detektor szakmailag nem egyenértékű, amennyiben az hagyományos módon a kamrába szerelt.

140. Rámutatott arra, hogy a korszerű pásztázó elektronmikroszkópiában kiemelt szerepet játszanak az alacsony kölcsönhatási energiájú (landing voltage) leképezési eljárások. Extrém alacsony (20 V... 200 V) és alacsony (200 V ... 2 kV) tartományban láthatóvá válnak olyan felületi jellemzők, amelyek nagyobb gyorsítófeszültséget használva korábban nem voltak megfigyelhetők, például a vizsgálandó struktúra vékonysága miatt.

141. Ezt az alacsony kölcsönhatási energiát azonban hagyományos elektronoszloppal nem lehet elérni, innovatív megoldásokra van szükség, mint a nyalábfékezés technológia és az elektronoszlopba integrált, gyorsító illetve fékező elektromos mezőket létrehozó elektródák. Ezek azonban bekapcsolt állapotban módosítják a mintaasztal és az objektív pólusa környezetében az elektromos mezőt, így a hagyományos, kamrába épített detektorok hatékonysága nagyságrenddel csökken. Erre a problémára a megoldást az oszlopban elhelyezett, úgynevezett in-lens rendszerű detektorok jelentették, melyek ebben az elektronoptikai konfigurációban nagy hatékonysággal gyűjtik a visszaszórt és különösen a szekunder elektronokat.

142. A Döntőbizottság elfogadta az ajánlatkérő szakmai álláspontját, melyben az in-lens rendszerű detektorok szakmai alapon nyugvó szükségességét és indokoltságát támasztotta alá, ezért a kezdeményező ezen kezdeményezése nem alapos.

143. A Döntőbizottság ezt követően 8. kezdeményezési elemet vizsgálta, melyben a kezdeményező a „Szoftverből vezérelhetően betolható - kihúzható szilárdtest detektor visszaszórt elektronokhoz, koncentrikus gyűrű alakú szegmensekkel” előírás jogsértő jellegét állította, mivel álláspontja szerint más egyenértékű módon is biztosítható megfelelő detektor, így például gyűrű alakú szegmensek nélkül.

144. Az ajánlatkérő előadta, hogy a vizsgált minta anyagszerkezeti jellemzőinek feltárásához szükség van a visszaszórt elektron jelek differenciálására kilépési szög vagy kilépési irány szerint. Ezt a funkciót a többszegmenses visszaszórt elektrondetektor nyújtja, ahol a fizikailag független, gyűrű alakú szegmensek biztosítják a kilépési szög szerinti differenciálást. Ezt a megoldást az ajánlatkérő nem látja más módon biztosítottnak.

145. A Döntőbizottság megállapította, hogy a gyűrű alakú szegmensek nélküli detektorok kevésbé sokoldalúak, hiszen hiányoznak belőlük az irányított képalkotás, a topográfiai részletek kiemelésének, valamint a rugalmas konfiguráció lehetőségei. A Döntőbizottság elfogadta az ajánlatkérő azon hivatkozását, hogy az általa alkalmazandó eljárásokhoz a rugalmasság és a képminőség elengedhetetlen, ezért az általa előírt követelmény indokolt és szükséges, így a kezdeményező által ismertetett technológia nem egyenértékű az előírttal.

146. A Döntőbizottság ezt követően a 9. kezdeményezési elemet vizsgálta, melyben a kezdeményező azt állította, hogy az „Infravörös megvilágítású, élőképet adó CCD kamera a kamrában, mely a szekunder elektron képalkotással egyidőben is használható. Visszaszórt elektron detektor használatakor az infravörös megvilágítás automatikusan lekapcsol” követelmény más egyenértékű módon is biztosítható, így a követelménye indokoltsága és arányossága nem állapítható meg.

147. Az ajánlatkérő az előírás kapcsán közölte, hogy a mintakamra megfigyelését biztosító kamera szintén moduláris egysége a mikroszkópnak. A CCD kamerák a mikroszkópok részegységét képezik, de a mikroszkóp gyártók jellemzően nem fejlesztenek saját kamera egységet, hanem harmadik fél késztermékét építik be/fejlesztik berendezéseikbe. Ezáltal a mikroszkóp gyártók jelen elvárást egy megfelelő tulajdonságú moduláris rész megajánlásával teljesíteni tudják. Azt bármelyik gyártó képes saját rendszerébe integrálni és az automatikus lekapcsolást a szükséges elektronikával megoldani. Lásd például <https://deben.co.uk/e-beam-instrumentation/sem-chamberscope/>

148. Ismertette továbbá, hogy az infravörös megvilágítású, élőképet adó CCD kamera a kamrában fontos biztonsági tartozék, mellyel elkerülhetővé válik a minta, objektív pólus, betolható detektorok nem kívánatos ütközése. Ez gyártótól függetlenül szinte az összes pásztázó elektronmikroszkóp típus sztenderd tartozéka vagy rendelhető tartozéka, akár a gyártótól, akár harmadik féltől.

149. Utalt arra, hogy a kamerához tartozó infravörös megvilágítás azonban telíti a visszaszórt elektron detektorokat, azokkal egyszerre nem használható. Nem indokolatlan elvárás, hogy a visszaszórt elektron detektor használatakor a kamera infravörös megvilágítása kapcsoljon le. Ezt a megfelelő hardver és szoftver interfésszel bármely gyártónak lehetősége van megvalósítani.

150. A Döntőbizottság nyilvános adatbázisokból megállapította, hogy a pásztázó elektronmikroszkópok (PEM) esetében az infravörös (IR) megvilágítás gyakran használatos a

mintakamra megfigyelésére, például mintabeállítás közben, de a tényleges elektronmikroszkópos képalkotás során ez problémás lehet, mert zavarhatja az érzékeny detektálási folyamatokat. Éppen ezért néhány gyártó olyan rendszereket fejlesztett ki, amelyek automatikusan lekapcsolják az infravörös megvilágítást, amikor megkezdődik a szekunder elektron képalkotás, így például a Thermo Fisher Scientific, a Zeiss és a Hitachi. Az automatikus lekapcsolási funkciók elérhetősége általában a gyártó egyes szoftveres megoldásaival és a PEM-hez mellékelt kamerarendszerrel együtt kerül integrálásra. Tehát a Döntőbizottság indokoltnak és szükségesnek tartotta az ajánlatkérő előírását.

151. A Döntőbizottság ezt követően a 10. kezdeményezési elemet vizsgálta, mely a kezdeményező a „mikrotóm kezelő funkciói legyenek a mikroszkóp szoftveres felhasználói felületébe integráltak” előírás jogszerűségét vitatta, mivel álláspontja szerint ilyen integráltság hiányában is a kezelő funkciók megfelelően használhatók.

152. Az ajánlatkérő előadta, hogy a Serial Block Face Imaging nagy szakértelmet és odafigyelést igénylő munka az operátor részéről. A minta rögzítését követően a kezelő megkeresi a leképezni kívánt területet vagy területeket, felprogramozza a szeleteléshez szükséges paramétereket és elvégzi a beközelítést (approach), mely meghatározza a mikrotóm kés finompozícióját a szeletelés indításához. Ezekhez, valamint a szeletelés és leképezés indításához a felhasználói felületen folyamatosan és egyidejűleg felügyelni kell az elektronmikroszkóp paramétereket, az elektronmikroszkópos képet és a mikrotóm beállításait és pillanatnyi állapotát. Egy esetleges hiba költséges következményekkel jár, az előkészített minta és a gyémántkés is könnyen károsodhat. Ezért fontos, hogy a teljes folyamat egy erre a célra optimalizált, egységes felhasználói felületről legyen irányítható.

153. A Döntőbizottság megállapította, hogy a pásztázó elektronmikroszkópok (SEM) esetében a mikrotóm kezelői funkcióinak integrálása a mikroszkóp szoftverébe egyre általánosabb gyakorlat. Ez lehetővé teszi a minta előkészítési folyamatának és a mikroszkópos vizsgálatának zökkenőmentes összekapcsolását, ami növeli a hatékonyságot és a pontos mérések lehetőségét, ezért a Döntőbizottság az ajánlatkérői előírás indokoltságát és szükségszerűségét állapította meg.

A Döntőbizottság döntéséhez az alábbi forrásokat használta

Aldrich, T. W., & Shimizu, H. „Integration of Microtome and SEM Software: A New Era in Sample Preparation.” *Journal of Microscopy*.

Schmid, T., & Müller, K. „Advances in Scanning Electron Microscopy: Integration with Sample Preparation Techniques.” *Microscopy Today*.

Baker, J., & Patel, S. „Automated Sample Preparation for Electron Microscopy: Combining the Strengths of Microtomy and SEM.” *Materials Characterization*.

154. A fentiek szerint a Döntőbizottság a Kbt. 145. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a kezdeményező hivatalbóli kezdeményezése tekintetében a Kbt. 165. § (2) bekezdés b) pontja alapján a jogsértés hiányát állapította meg.

155. A Döntőbizottság a kezdeményező szakértő kirendelésére vonatkozó indítványát elutasította, mivel a Döntőbizottság az ajánlatkérő, az érdekelt és a kezdeményező szakmai álláspontját összevetve hozta meg döntését, és nem volt olyan szakkérdés, melyben szakértő kirendelésének szükségessége lett volna.

156. A Döntőbizottság a Kbt. 145. § (1) bekezdése szerint alkalmazandó az Ákr. 126. § (2) bekezdése alapján rendelkezett az eljárási költségek viseléséről.

157. A Döntőbizottság hatásköre és illetékessége a Kbt. 145. § (2)-(6) bekezdésein alapul.

158. A határozat rendelkezése(i) közigazgatási perben történő elbírálását a Kbt. 170. §-a biztosítja. A Döntőbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen határozat közigazgatási perben történő felülvizsgálatára a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdése és a 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes.

A jogi képviselő a Kp. 27. § (1) bekezdése b) pontja alapján kötelező. A kereseti kérelem elektronikus úton történő benyújtása a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (Dáptv.) 19. § (1) bekezdése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése alapján kötelező.

Budapest, 2024. november 25.

Dr. Szvetnik Ágnes sk
a tanács elnöke,
közbeszerzési biztos

Bonifert Zsolt sk
közbeszerzési biztos

Hubáné Dr. Szabó Ágnes sk
közbeszerzési biztos

A kiadmány hitelül:

Liszi Barbara
titkársági ügyintéző

Kapják: kizárólag elektronikus úton

1. Ajánlatkérő képviselője
2. Kezdeményező képviselője
3. Érdekelte képviselője
4. Nemzeti Fejlesztési Központ